

thermo scientific

Nicolet RaptIR+

Microscope FTIR



GUIDE D'UTILISATION

269-3625 02

Révision A

janvier 2024

ThermoFisher
SCIENTIFIC

Sommaire

1. Introduction	5
1.1 Utilisation prévue	6
1.2 Clause de non-responsabilité	7
1.3 Conventions employées	8
1.4 Informations relatives à la garantie	9
1.5 Étiquettes de sécurité du microscope	10
2. Aperçu	11
2.1 Fonctions et commandes	12
2.2 Connexions et ports	15
2.3 Manette en option	16
2.4 Trinoculaire en option	17
2.5 Utilisation du logiciel OMNIC Paradigm	18
3. Fonctionnement	22
3.1 Préparation du microscope	23
3.2 Détecteurs interchangeables par l'utilisateur	26
3.3 Analyse d'échantillons	33
3.4 Mesures ATR	41
3.5 Émission sur le côté droit	47
3.6 Localisation, éclairage et masquage de l'échantillon	48
3.7 Vérification de la performance du microscope	54
3.8 Utilisation du polariseur	56
3.9 Mesure de données de point unique	60
3.10 Utilisation de l'objectif à angle d'incidence (en option)	63
3.11 Contraste d'interférence différentielle (en option)	65
3.12 Illuminateur de fluorescence (en option)	67
3.13 Utilisation de la platine Linkam en mode Transmission	71
4. Maintenance	80
4.1 Nettoyage du microscope	81

4.2 Maintenance du vase de Dewar d'azote liquide	82
4.3 Stockage et expédition de votre détecteur	83
5. Dépannage	85
6. Nous contacter	88

© 2024 Thermo Fisher Scientific Inc. Tous droits réservés.

Microsoft, Windows et Excel sont des marques de commerce ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et / ou dans d'autres pays. Teflon est une marque de commerce de Chemours aux États-Unis et / ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques mentionnées sont la propriété de Thermo Fisher Scientific Inc. et de ses filiales.

Pour obtenir une assistance technique, veuillez contacter : www.thermofisher.com.

Thermo Fisher Scientific Inc. fournit cette documentation à l'achat d'un produit. Cette documentation est protégée par copyright et toute reproduction intégrale ou partielle de celle-ci est formellement interdite, sauf autorisation écrite de Thermo Fisher Scientific Inc.

Le contenu de cette documentation peut faire l'objet de modifications sans préavis. Toutes les informations techniques contenues dans le présent document sont fournies à titre de référence uniquement. Les configurations et spécifications qui y sont indiquées prévalent sur toute autre information précédemment communiquée à l'acheteur.

Thermo Fisher Scientific Inc. n'affirme en aucun cas que cette documentation est complète, précise ou exempte d'erreurs et décline toute responsabilité et ne peut être tenu responsable de toute erreur, omission, perte ou tout dommage causés par l'utilisation de la présente documentation, même si les informations qu'elle contient sont soigneusement respectées.

Ce document ne fait partie d'aucun contrat de vente passé entre Thermo Fisher Scientific Inc. et un acheteur. Ce document ne régit pas et ne modifie en aucune manière les Conditions de vente, lesquelles régissent la résolution de tous les conflits pouvant survenir entre ces deux documents.

Usage exclusivement réservé à la recherche. Cet instrument ou accessoire n'est pas un dispositif médical et n'est pas conçu pour être utilisé pour la prévention, le diagnostic, le traitement ou la guérison de maladies.

AVERTISSEMENT



Évitez tout risque d'explosion ou d'incendie.

Cet instrument ou accessoire n'est pas conçu pour être utilisé dans une atmosphère explosive.

1. Introduction

1.1 Utilisation prévue

Le microscope FTIR Thermo Scientific Nicolet RaptIR, un microscope à transformée de Fourier (FTIR) conçu pour être utilisé dans un environnement de laboratoire contrôlé, doit être utilisé avec les spectromètres de la série Nicolet.

Avec le microscope RaptIR, vous pouvez rapidement identifier votre cible, collecter des images visuelles à haute résolution, et générer des données IR à haute résolution spatiale à des fins d'analyse.

Le logiciel OMNIC Paradigm comprend une suite complète d'outils analytiques, des flux de travail personnalisables pour automatiser vos tâches de routine, et des outils faciles à utiliser pour l'analyse des microparticules ainsi que l'analyse d'aires, de points et de lignes.

Avec le microscope RaptIR, vous pouvez analyser des échantillons épais (jusqu'à 4 cm) et lourds (jusqu'à 5 kg). De plus, grâce à plusieurs objectifs et une tourelle porte-objectifs automatisée, il offre une vaste gamme d'options pour visualiser les échantillons et collecter des données IR.

1.2 Clause de non-responsabilité

N'utilisez pas le microscope à des fins autres que son usage prévu, comme décrit dans le présent manuel de l'utilisateur.

AVIS

Avant d'utiliser le microscope, lisez les renseignements relatifs au site et à la sécurité de votre système.

1.3 Conventions employées

Les mesures de sécurité et les autres informations importantes utilisent le format suivant :

DANGER



Évitez tout danger. Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraînera la mort ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT



Évitez tout danger. Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

ATTENTION



Évitez tout danger. Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures légères ou modérées.

AVIS

Suivez les instructions précédées de cette mention afin d'éviter d'endommager le matériel système ou de perdre des données.

Remarque Contient des informations supplémentaires utiles.

1.4 Informations relatives à la garantie

Thermo Fisher Scientific garantit que chacun des produits que nous vendons est exempt de défauts de matériaux ou de fabrication, et est conforme à ses spécifications produit telles que définies dans la documentation utilisateur du produit. Si le produit ne fonctionne pas comme garanti pendant la période de garantie, nous le réparerons ou le remplacerons sans frais. Si nous sommes à notre appréciation dans l'impossibilité de le faire, vous pouvez nous retourner le produit et nous vous rembourserons.

Cette garantie remplace toutes les autres garanties, expresses ou implicites, y compris les garanties implicites de qualité marchande ou d'aptitude à un usage particulier et toutes les autres obligations ou responsabilités de la part de Thermo Fisher Scientific, qu'elles soient basées sur un contrat, une garantie, la négligence ou autre.

Thermo Fisher Scientific ne saurait être tenue responsable et décline toute responsabilité en cas de dommages consécutifs, accessoires et indirects.

1.4.1 Période de garantie

La période de garantie du système est de 12 mois aux États-Unis et au Canada. La période de garantie commence à la date d'installation ou 30 jours à compter de la date de facturation, la première de ces deux échéances prévalant.

La période de garantie du système pour les produits vendus en dehors des États-Unis et du Canada est de 12 mois à compter de la date d'installation ou de 14 mois à compter de la date d'expédition, la première de ces deux échéances prévalant.

1.4.2 Limite de garantie

Tout usage abusif, accident, modification, environnement physique ou d'exploitation inadapté, maintenance abusive ou dommage causé par un produit pour lequel nous ne serions pas responsables annulera la garantie.

Les consommables ne sont pas couverts par la garantie.

Nous ne garantissons pas le fonctionnement ininterrompu ou sans erreur d'un produit. Nous fournissons certains produits qui ne sont pas de marque Thermo Fisher Scientific "tels quels". Les fabricants ou fournisseurs autres que Thermo Fisher Scientific peuvent fournir leurs propres garanties. Une garantie distincte est fournie pour le logiciel avec la documentation de l'utilisateur du logiciel.

AVIS

À l'intérieur du carton d'expédition, l'instrument est enveloppé dans un sac plastique hermétique pour conserver les composants optiques secs. Attendez 24 heures pour ouvrir le sac - le temps que l'instrument atteigne la température ambiante. Si vous ouvrez le sac avant que l'instrument n'atteigne la température ambiante, l'humidité risque de se condenser sur les composants optiques et de les endommager de manière irréversible.

Votre garantie ne couvre pas :

- les dommages imputables à des techniques de déplacement inadéquates ;
- les pièces manquantes ou endommagées si les cartons d'expéditions sont déballés avant que notre technicien de maintenance installe le système ;
- les dommages dus au retrait du sac plastique hermétique avant que l'instrument n'arrive à température ambiante.

1.5 Étiquettes de sécurité du microscope

Votre microscope est fourni avec de nombreuses étiquettes de sécurité. Lisez tous les textes de mise en garde pour éviter tout danger ou toute blessure.

⚠️ WARNING		⚠️ AVERTISSEMENT	
Use only nitrogen or dry air for purge.		Utiliser uniquement de l'azote ou de l'air sec pour la purge.	
Purge In Aspiration de purge			
20.0 psi (138.0 kPa) maximum		20.0 psi (138.0 kPa) maximum	

A	Current Max.	9A
⚡	DC Voltage	12V DC
Model: Nicolet RaptIR Nicolet RaptIR+		

CE UK CA 10 C ETL US

Intertek 58595

Conforms to Std. UL61010-1 Cert. to CSA Std C22.2 No. 61010-1-12

ThermoFisher
S C I E N T I F I C
Thermo Fisher Scientific
5225 Verona Rd.
Madison, WI 53711
Assembled in USA

Warranty VOID if serial number is removed.
China RoHS: <http://www.thermofisher.com/us/en/home/technical-resources/rohs-certificates.html>
Patent: www.thermofisher.com/patents

⚠️ **WARNING**

⚠️ **AVERTISSEMENT**

Liquid nitrogen exposure
Exposition à l'azote liquide

⚠️ **NOTICE**

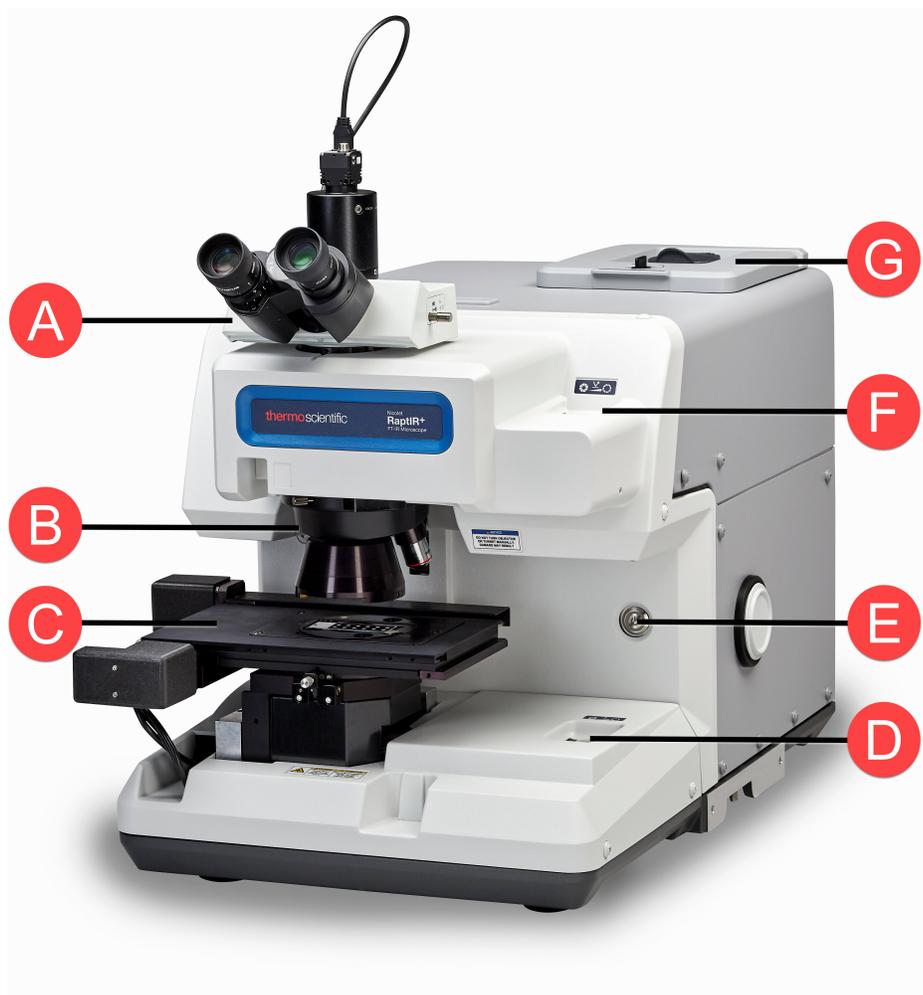
DO NOT TURN OBJECTIVE OR TURRET MANUALLY. DAMAGE MAY RESULT

	⚠️ CAUTION	⚠️ ATTENTION
	Pinch Point Keep hands clear of moving parts.	Point de pincement Garder les mains à l'écart des pièces mobiles.

2. Aperçu

2.1 Fonctions et commandes

Figure 2-1 : principales fonctions du microscope



A	Trinoculaire vidéo	Le trinoculaire vidéo en option génère à la fois une image visuelle et vidéo dans le logiciel OMNIC Paradigm. Le monoculaire (non illustré) ne génère qu'une vidéo.
B	Tourelle d'objectifs rotative	La tourelle peut accueillir 1 objectif IR et 1 objectif visuel. Généralement, vous utiliserez un objectif IR 15x et un objectif visuel 4x. Le microscope peut également utiliser des objectifs visuels GAO et 40x en option.
C	Platine motorisée	La platine offre une distance de travail de 40 mm et peut accueillir des échantillons pesant jusqu'à 5 kg. Commandez la platine via le logiciel OMNIC Paradigm ou à l'aide de la manette en option. N'essayez jamais de déplacer la platine à la main.

D	Transmission Iris d'éclairage	Utilisez l'iris du champ de vision pour ajuster la taille du champ de vision éclairé. Il s'ouvre et se ferme de manière concentrique.
		Généralement, l'iris est complètement ouvert afin d'être en dehors de l'intégralité du champ de vision. Si la surface d'un échantillon n'est pas uniforme, il peut être plus facile d'effectuer la mise au point sur les bords des lames de l'iris afin d'obtenir la meilleure mise au point possible.
E	Voyant et bouton d'alimentation	Appuyer sur ce bouton pour mettre en marche ou arrêter le microscope. Le voyant d'alimentation bleu clignote lorsque le microscope est en cours de démarrage et passe au bleu fixe lorsqu'il est prêt à l'emploi.
F	Réflexion Iris d'éclairage	Utilisez l'iris du champ de vision pour ajuster la taille du champ de vision éclairé. Il s'ouvre et se ferme de manière concentrique par rapport au réticule.
		Généralement, l'iris est complètement ouvert afin d'être en dehors de l'intégralité du champ de vision. Si la surface d'un échantillon n'est pas uniforme, il peut être plus facile d'effectuer la mise au point sur la zone d'intérêt si vous fermez d'abord partiellement l'iris puis effectuez la mise au point sur les bords des lames de l'iris.
G	Trappe de détection interchangeable et vase de Dewar d'azote liquide de 1 litre	La trappe de détection peut s'ouvrir pour permettre l'échange de détecteurs. Le vase de Dewar d'azote liquide contient 1 litre d'azote liquide. Une fois refroidi, le détecteur restera froid pendant 18 heures environ.

Figure 2-2 : Gros plan de la platine

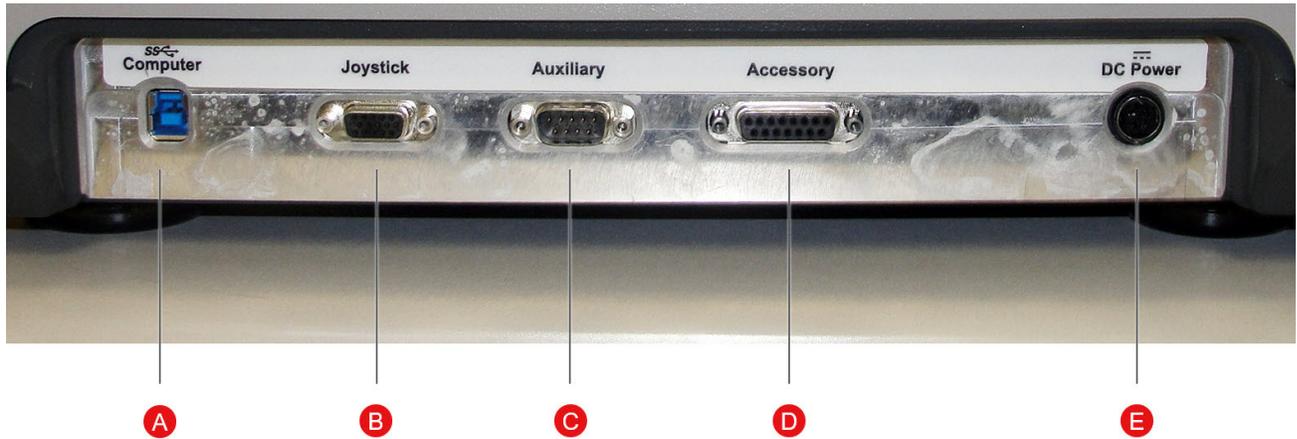


A	Détecteur ATR	Le détecteur ATR détecte si l'accessoire ATR insérable est installé.
B	Diapositive d'exemple indicateur d'alignement	Permet d'aligner les points indicateurs rouges sur la platine et la lame de l'échantillon.

2. Aperçu

- | | | |
|----------|--|--|
| C | Molette
d'orientation
de la platine | Utilisée pour faire pivoter la platine pendant l'installation. Ne l'utilisez pas après l'installation. |
| <hr/> | | |
| D | Accessoire ATR
insérable | L'accessoire ATR insérable en option est utilisé pour les mesures ATR. |

2.2 Connexions et ports



A Connexion USB 3.0 au port USB 3.0 d'un ordinateur

B Connexion à la manette en option

C Connexion au port "Auxiliary Signals" (Signaux auxiliaires) du spectromètre

D Connexion au port "Accessory" (Accessoire) du spectromètre

E Connexion au câble d'alimentation secteur

2.3 Manette en option

Vous pouvez utiliser la manette en option pour contrôler la position de la platine et l'éclairage de l'échantillon. La platine et l'éclairage peuvent également être contrôlés dans le logiciel.

Pour connecter la manette, branchez le câble de données dans le port "Joystick" (Manette) situé à l'arrière du microscope.



A	Commande d'éclairage par transmittance	Tournez le bouton pour atténuer ou augmenter la luminosité de l'éclairage par transmittance.
B	Dispositif d'éclairage de réflexion	Tournez le bouton pour atténuer ou augmenter la luminosité de l'éclairage par réflectance.
C	Manette de commande de la platine	Poussez la manette vers l'avant, vers l'arrière, vers la gauche ou vers la droite pour déplacer la platine sur le plan de l'échantillon. Tournez la manette pour faire monter ou descendre la platine.
D	Commande de vitesse	Permet de contrôler la vitesse de déplacement de la platine pour des mouvements lents et précis ou des mouvements rapides.

2.4 Trinoculaire en option

Votre microscope peut être équipé d'un monoculaire avec la caméra uniquement ou peut être équipé du trinoculaire avec la caméra et des oculaires visuels



A	Oculaires visuels	Oculaires réglables pour examiner l'échantillon. Utilisation optimale avec la manette en option.
B	Sélecteur de vue à trois positions	Contrôle le trajet optique des oculaires. <ul style="list-style-type: none">• In (Entrée) : oculaire uniquement, pas de caméra• Middle (Milieu) : oculaire et caméra• Out (Sortie) : caméra uniquement, pas d'oculaires
C	Caméra	La caméra USB est utilisée avec le logiciel OMNIC Paradigm.

2.5 Utilisation du logiciel OMNIC Paradigm

Utilisez votre microscope et analysez vos échantillons à l'aide du logiciel OMNIC Paradigm, le logiciel d'analyse de matériaux simplifié de Thermo Scientific. L'écran convivial du tableau de bord vous aide à visualiser l'état de l'instrument et les travaux récents, traiter vos spectres, réaliser une recherche multi-composants, et créer de nouvelles bibliothèques. Conçu pour répondre aux besoins des responsables de laboratoire et des enseignants en sciences, ce logiciel aide à automatiser les flux de travail à l'aide d'un créateur de flux de travail intuitif utilisant la méthode par glisser-déposer. Travaillez à distance et collaborez avec des collègues du monde entier lorsque vous téléchargez les données du logiciel OMNIC Paradigm sur le cloud en utilisant l'application Thermo Scientific OMNIC Anywhere.

2.5.1 Interface

En microscopie, vous travaillerez principalement dans les vues Tableau de bord et Session.

Tableau de bord

Le tableau de bord vous permet de démarrer une nouvelle session, de modifier les paramètres de mesure, d'afficher les mesures récentes, les rapports, les sessions, et de visualiser les flux de travail.

Figure 2-1 : Tableau de bord affichant les outils de microscopie

The screenshot displays the OMNIC Paradigm software interface. The top menu bar includes File, Acquire Data, Display, Process, Identify, Configure, and Help. Below the menu is a toolbar with icons for Open Spectrum, Dashboard, Microscope Setup, and other functions. The main area is divided into several sections:

- New Measurement:** A section for configuring a new measurement with fields for Session name, Final format (Absorbance), Sample scans (1), Mosaic capture (Center of glass slide), Camera profile, Tag, Resolution (cm-1) (16), Profile (Peak), Analyze using (Reflection), and Analyze particles (checkbox). Parameters like Step size, Aperture height, and Aperture width are set to 100.
- Measurements:** A table listing recent measurements with columns for Measurement Name, Last Modified, and Type. The table shows several entries for Factory and PHEUR measurements.
- Workflows:** A section for managing workflows with a table listing Name, Date Created, and Last Modified. It includes workflows like Accessory Performance Test, ATR Accessory - PHEUR Qualification, ATR Accessory - PV Test, and Nicolet FTIR - CP Qualification.
- Preview:** A section showing a spectral plot for a Factory - ATR RaptIR Measure Sample.

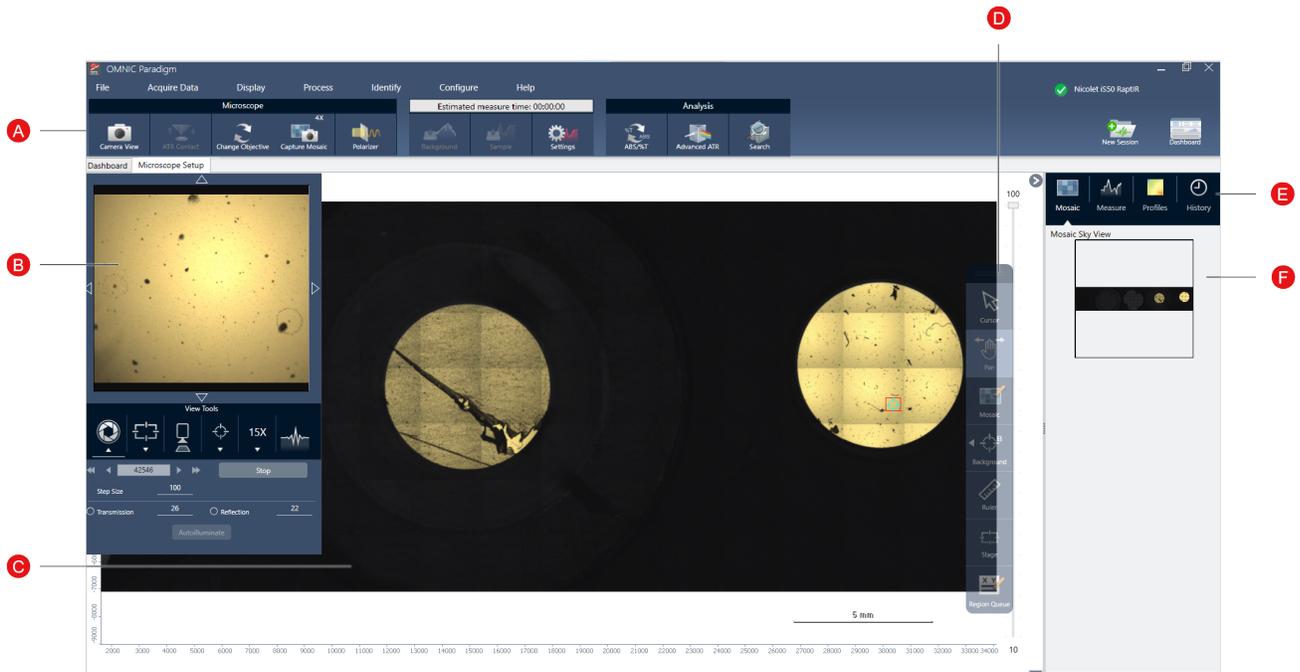
Red letters A through J are placed around the interface to highlight specific features: A (Open Spectrum), B (Start Session), C (Eject Stage), D (Measurements table), E (Workflows table), F (Menu bar), G (New Measurement buttons), H (Parameters), I (Spectral plot), and J (Thermo Scientific logo).

A	Barre d'outils	La barre d'outils comprend des boutons associés aux fonctions et outils que vous utiliserez fréquemment. Elle est utilisée pour naviguer entre le tableau de bord et les vues Map (Carte) et Spectral (Vue spectrale).
B	Démarrer la session	Après avoir chargé votre échantillon et sélectionné un emplacement de capture de mosaïque, cliquez sur Start Session (Démarrer la session) pour passer à la vue Session et collecter automatiquement une image mosaïque de l'échantillon. Sélectionnez Autofocus before capture (Mise au point auto avant capture) pour effectuer automatiquement la meilleure mise au point de l'échantillon.
C	Éjecter la platine	L'éjection de la platine est facultative. La fonction d'éjection permet d'abaisser la platine et la déplacer vers l'avant afin d'avoir plus de place pour charger votre échantillon. Une fois l'échantillon chargé, cliquez sur Démarrer la session pour faire revenir la platine à sa position d'origine, ou déplacez-la manuellement.
D	Mesures, Sessions et Rapports	Permet d'afficher vos mesures, sessions et rapports. Choisissez une catégorie dans la liste pour changer de vue.
E	Flux de travail et Packages	Permet d'afficher les flux de travail de qualification et de vérification de performance ainsi que vos flux de travail personnalisés. Pour en savoir plus sur la création et l'utilisation des flux de travail, reportez-vous aux guides et tutoriels du logiciel OMNIC Paradigm.
F	Paramètres	Permet de créer, de sélectionner, d'enregistrer ou de supprimer des collections de paramètres.
G	Plus	Cliquez sur Plus pour agrandir une des sections principales du tableau de bord et afficher des paramètres ou détails supplémentaires.
H	Paramètres de collecte	Les paramètres les plus couramment utilisés sont affichés ici, dans le panneau Nouvelle mesure. Cliquez sur Plus pour afficher des paramètres avancés supplémentaires, y compris des paramètres pour les mesures du bruit de fond.
I	Aperçu	Permet d'afficher une image de prévisualisation de la mesure, carte ou rapport sélectionné(e).
J	Aperçu d'un flux de travail ou d'un package	Permet d'afficher une image de prévisualisation du flux de travail ou package sélectionné. Les flux de travail verrouillés affichent un logo à la place de l'aperçu du flux de travail.

Vue Session de microscopie

Analysez votre échantillon en utilisant la vue Session. Dans cette vue, vous pouvez visualiser votre échantillon, définir des zones d'intérêt pour votre analyse, et mesurer des données d'échantillon.

Figure 2-2 : Vue Session de microscopie dans le logiciel OMNIC Paradigm.



A Barre d'outils Permet d'afficher des paramètres du microscope supplémentaires et d'ouvrir la vue de la caméra en direct, de capturer une nouvelle mosaïque, de mesurer un spectre, ou de revenir au tableau de bord.

B Vue de la caméra Ouvrez la vue de la caméra pour afficher l'image visuelle en direct de l'échantillon. Utilisez Afficher outils pour ajuster l'éclairage, la mise au point, l'ouverture, et pour prendre un rapide instantané de la mosaïque, changer d'objectif, ou visualiser un signal d'interférogramme en direct.

Utilisez les flèches autour de l'image en direct pour déplacer la platine sans manette.

C Vue Mosaïque Permet d'afficher l'image mosaïque. Il s'agit de l'espace de travail principal dans lequel vous définissez votre point de bruit de fond et les régions pour l'analyse.

D	Barre d'outils flottante	<p>Outils d'analyse et de navigation pour interagir avec l'image mosaïque.</p> <ul style="list-style-type: none">• Curseur : permet de sélectionner des régions, des points et des spectres• Pan : permet de déplacer la partie visible de la mosaïque• Mosaïque : permet de dessiner une région pour obtenir une mosaïque à fort grossissement• Outils d'analyse<ul style="list-style-type: none">• Point du bruit de fond : permet de sélectionner un point où vous mesurerez le spectre de bruit de fond• Aire : permet de dessiner une aire pour l'analyse d'une région• Point : permet de sélectionner un point pour mesurer un spectre• Ligne : permet de mesurer une carte linéaire• Analyse des particules : permet de dessiner une région pour l'analyse des particules (cet outil est uniquement disponible lorsque l'analyse de particules est sélectionnée sur le tableau de bord)• Règle : permet de mesurer des objets dans la vue Mosaïque• Platine : cliquez sur un point de la mosaïque pour déplacer la platine à cette position• File d'attente des régions : permet d'afficher l'ensemble des régions et points actuellement sélectionnés pour votre analyse (ce sont les positions qui seront mesurées lorsque vous cliquez sur Sample [Échantillon])
E	Panneau Analyse	<p>Le panneau Analyse permet d'afficher vos mosaïques, spectres de bruit de fond, profils et l'historique.</p>
F	Vue Mosaic Sky	<p>Cette vue permet d'afficher une vue d'ensemble de la mosaïque. Lorsque vous effectuez un zoom avant, cette vue vous montre la partie de la mosaïque que vous visualisez. Vous pouvez utiliser cette vue pour naviguer sur toute la mosaïque.</p>

3. Fonctionnement

3.1 Préparation du microscope

Pour commencer votre analyse, refroidissez le détecteur du microscope (le cas échéant), mettez le système sous tension et démarrez le logiciel OMNIC Paradigm.

3.1.1 Mise sous tension de l'ordinateur

Avant d'allumer le microscope (le mettre sous tension), allumez l'ordinateur et attendez que l'écran d'identification de Windows apparaisse. Si vous allumez le microscope avant d'allumer l'ordinateur, le logiciel OMNIC Paradigm risque de ne pas pouvoir communiquer avec le microscope ou la caméra.

- Si cela se produit, éteignez le microscope et rallumez-le.
- Si le problème persiste, éteignez l'ordinateur et le microscope. Démarrez l'ordinateur et attendez que l'écran de connexion s'affiche. Allumez ensuite le microscope.

3.1.2 Mise sous tension du microscope et du spectromètre

Mise sous tension du spectromètre. Voir le guide d'utilisation du spectromètre pour connaître les instructions.

Pour allumer le microscope (le mettre sous tension), appuyez sur le bouton d'alimentation situé sur le panneau avant. Le voyant bleu clignote pendant l'initialisation et passe au bleu fixe lorsque le microscope est prêt à l'emploi.



3.1.3 Démarrage du logiciel OMNIC Paradigm.

Utilisez le logiciel OMNIC Paradigm pour commander le microscope et analyser votre échantillon.

Lorsque vous démarrez le logiciel et mettez le microscope sous tension pour la première fois, le logiciel contrôle les limites de mouvement de la platine afin de vérifier que tout fonctionne correctement.

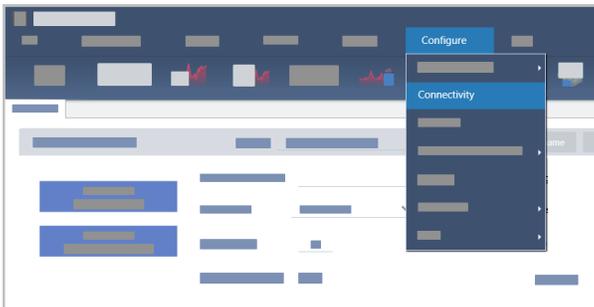
◆ Pour démarrer le logiciel OMNIC Paradigm et le connecter au microscope

1. Démarrez le logiciel OMNIC Paradigm.
2. Si le logiciel est déjà connecté au microscope, l'état de l'instrument affiche Nicolet iS50 RaptIR et une coche verte.

Figure 3-1 : Coche verte dans le logiciel OMNIC Paradigm



3. Si le logiciel n'est pas connecté à l'instrument, connectez-le maintenant.
 - a. Accédez à **Configure > Connectivity (Configuration > Connectivité)** et sélectionnez le spectromètre. Cliquez sur **Connect (Connecter)**.



- b. Pour passer en vue Microscopy (Microscopie), accédez à **Configure > Sample Location > Right Microscope (Configuration > Emplacement d'échantillon > Microscope de droite)**. Le tableau de bord change pour afficher les outils de microscopie. Pour revenir aux outils de spectroscopie, modifiez à nouveau l'emplacement de l'échantillon en choisissant un autre accessoire ou module sur votre spectromètre principal.

3.1.4 Refroidissement de votre détecteur

Votre microscope peut utiliser des détecteurs MCT refroidis à l'azote liquide. Avant d'utiliser le microscope avec ces détecteurs, vérifiez toujours que la quantité d'azote liquide dans le vase de Dewar est suffisante.

Pour plus d'informations sur les détecteurs à votre disposition, consultez la section [Détecteurs interchangeable par l'utilisateur](#).

Le vase de Dewar d'azote liquide contient 1 litre d'azote liquide. S'il est refroidi selon la procédure suivante, le détecteur devrait rester froid pendant 18 heures environ.

AVERTISSEMENT



Évitez les engelures.

L'azote liquide est extrêmement froid et, par conséquent, dangereux.

- Portez des vêtements et des lunettes de protection et respectez les pratiques standard de sécurité des laboratoires pour éviter toute blessure.
- Versez l'azote liquide lentement. Il existe un risque d'éclaboussures si vous versez l'azote trop rapidement.

◆ Pour remplir le vase de Dewar avec de l'azote liquide

1. Ouvrez le couvercle du vase de Dewar et retirez le bouchon en plastique.
2. Insérez l'entonnoir dans le vase de Dewar du détecteur, et versez l'azote liquide lentement dans l'entonnoir. (Une petite quantité d'azote liquide déborde généralement de l'entonnoir. Cela n'endommagera pas votre instrument.) Laissez ensuite l'azote liquide s'écouler complètement et répétez l'opération à deux ou trois reprises. Attendez que le panache de vapeur se dissipe puis répétez l'opération jusqu'à ce que le vase de Dewar soit rempli. Continuez à remplir lentement l'entonnoir jusqu'à ce que 1 litre d'azote liquide soit introduit ou jusqu'à observer des bulles d'azote sous l'entonnoir. À ce stade, arrêtez le remplissage.
3. Retirez l'entonnoir.
4. Attendez que le panache de vapeur se dissipe, puis attendez encore 5 minutes avant de refermer le couvercle du vase de Dewar afin que le joint puisse dégeler.
5. Attendez 20 minutes, puis répétez la procédure jusqu'à ce que le vase de Dewar soit rempli.

3.2 Détecteurs interchangeables par l'utilisateur

Le microscope RaptIR+ est compatible avec plusieurs détecteurs facilement interchangeables pour vous aider à optimiser votre collecte de données. Chaque détecteur disponible est reconnu par le logiciel OMNIC Paradigm lors de l'installation et charge ses propres paramètres prédéfinis en usine, mais vous êtes libre de créer vos propres paramètres en fonction de vos besoins d'analyse.

Les détecteurs sont universels et fonctionneront sur n'importe quel appareil RaptIR+ sans réétalonnage. Ils peuvent également être échangés sans couper l'alimentation.

Utilisez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) lors de la manipulation des détecteurs.

Les détecteurs disponibles pour le microscope sont :

Détecteur	Description	Domaine spectral
MCT-A	Détecteur rapide à haute sensibilité avec domaine spectral limité. Nécessite de l'azote liquide.	7 800-650 cm ⁻¹
MCT-B	Détecteur rapide avec 20 à 30 % de sensibilité en moins par rapport au MCT-A, mais un domaine spectral plus large pour les vibrations à basse fréquence, idéal pour travailler avec des polymères et d'autres matériaux inorganiques. Nécessite de l'azote liquide.	7 800-450 cm ⁻¹
InGaAs	Détecteur spécialisé dans le proche infrarouge avec un domaine spectral élevé, idéal pour les produits pharmaceutiques. Ne nécessite pas d'azote liquide. Notez que le détecteur InGaAs nécessite une configuration de séparateur de faisceau CaF ₂ ou XT-KBr (de préférence la première) pour fonctionner correctement. Ceci est configuré au moment de l'achat.	11 700-3 800 cm ⁻¹
TEC-MCT	Détecteur de sensibilité inférieure refroidi par TE. Ne nécessite pas d'azote liquide. Veuillez prévoir jusqu'à une minute pour amener ce détecteur à température.	7 800-1 000 cm ⁻¹

AVERTISSEMENT



Évitez tout danger. Assurez-vous que les vases de Dewar du détecteur sont vides avant de les déplacer. N'essayez pas de retirer un détecteur avec de l'azote liquide dans le vase de Dewar.

ATTENTION



Évitez tout danger. Ne laissez rien tomber dans la chambre du détecteur lorsque les couvercles sont ouverts.

3.2.1 Pour installer un détecteur interchangeable RaptIR+

1. Ouvrez la trappe supérieure du microscope RaptIR+. Si elle est verrouillée, tournez le loquet principal en position “déverrouillé” pour l’ouvrir.

Si un détecteur est déjà présent à l’intérieur, désinstallez-le en suivant les instructions de la section [Pour désinstaller un détecteur interchangeable RaptIR+](#).

Figure 3-1 : Trappe supérieure, fermée et ouverte

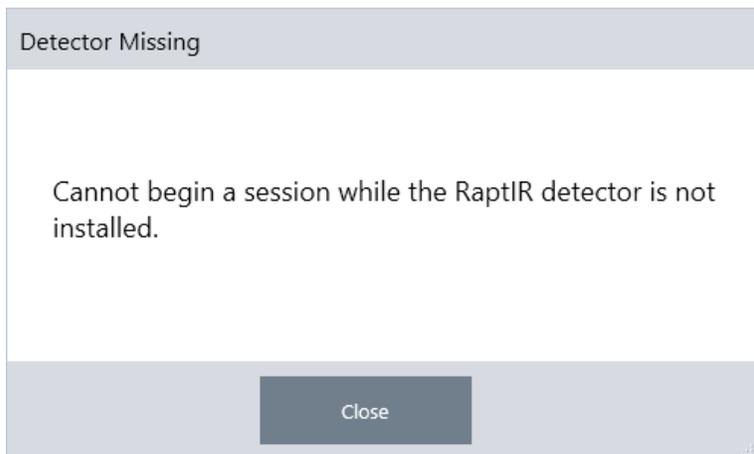


Figure 3-2 : Loquet : position verrouillée et position déverrouillée



Remarque Le logiciel OMNIC Paradigm recherche un détecteur toutes les cinq secondes. Il est impossible de commencer une session de mesure de données sans qu’un détecteur soit installé. Si cela se produit, une fenêtre contextuelle apparaît comme un avertissement.

Figure 3-3 : Boîte contextuelle “Detector Missing” (Détecteur manquant) dans le logiciel OMNIC Paradigm



2. Soulevez le détecteur de votre choix par les poignées et placez-le dans le réceptacle. Guidez doucement le détecteur jusqu'au fond. Ne le laissez pas tomber. Les détecteurs disponibles incluent MCT-A, MCT-B, InGaAs et TEC-MCT.

Figure 3-4 : Levage / insertion d'un détecteur



3. Lorsque le détecteur est en place, tournez les deux petits loquets en position “verrouillée” jusqu'à ce qu'ils soient bien serrés pour fixer le détecteur sur l'appareil.

Figure 3-5 : Loquet du détecteur



4. Fermez la trappe supérieure et tournez le loquet principal en position “verrouillé”.

Figure 3-6 : Loquet supérieur (verrouillé)



5. (En option) La trappe supérieure comprend un orifice de remplissage d'azote liquide pour les détecteurs qui en ont besoin.

Pour remplir le port, consultez la section [Refroidissement de votre détecteur](#).

Figure 3-7 : Orifice de remplissage du vase de Dewar (fermé, ouvert)



3.2.2 Pour désinstaller un détecteur interchangeable RaptIR+

AVIS

N'essayez pas de supprimer un détecteur pendant une session de mesure de données dans le logiciel OMNIC Paradigm. Cela permet de fermer et d'interrompre automatiquement votre session.

1. Ouvrez la trappe supérieure du microscope RaptIR+. Si elle est verrouillée, tournez le loquet principal en position "déverrouillé" pour l'ouvrir. (Attendez que le vase de Dewar soit vide avant de retirer le détecteur.)

Figure 3-8 : Ouverture du loquet avec le détecteur à l'intérieur



Figure 3-9 : Loquet : positions verrouillée et déverrouillée



2. À l'intérieur, tournez les deux petits loquets du détecteur en position "déverrouillée".

Figure 3-10 : Loquets de détecteur déverrouillés



3. Soulevez le détecteur par ses poignées pour le retirer de la prise, puis placez-le en lieu sûr sur une surface plane et immobile.

Figure 3-11 : Levage / insertion d'un détecteur



4. Fermez la trappe supérieure du microscope RaptIR + (ou insérez un nouveau détecteur), puis tournez le loquet principal en position "verrouillée".

Remarque Pour protéger au mieux vos détecteurs, rangez-les dans leur emballage d'origine.

3.2.3 Optimisation des détecteurs interchangeables

L'optimisation de vos détecteurs est importante pour garantir la qualité de vos données spectrales. Le logiciel OMNIC Paradigm vous alerte avec une icône d'état du système jaune lorsqu'une optimisation est recommandée.

L'optimisation règle le gain du système pour améliorer la sensibilité tout en garantissant que les signaux ne saturent pas le détecteur.

Remarque Si vous utilisez un détecteur refroidi à l'azote liquide, attendez qu'il refroidisse avant d'effectuer les étapes d'optimisation. Reportez-vous à la section [Refroidissement de votre détecteur](#) pour plus de détails.

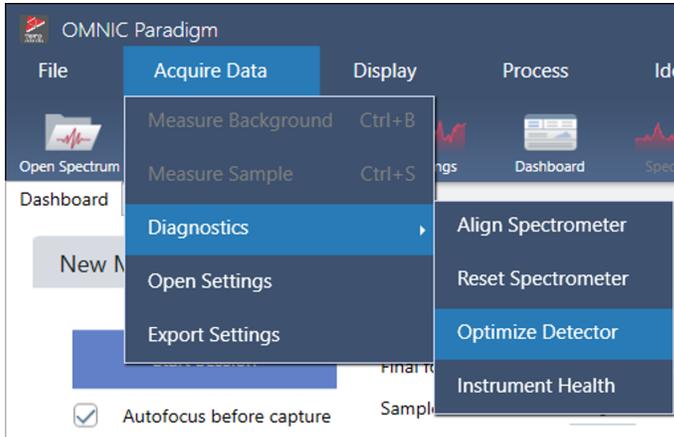
Remarque L'optimisation doit être effectuée avec la source et le séparateur de faisceau par défaut, corrects et installés. Si l'optimisation échoue, car la configuration correcte n'est pas disponible pour d'autres raisons, cela n'indique pas nécessairement un problème ou n'empêche pas l'utilisation de votre système.

Cliquez sur l'icône d'état dans le coin supérieur droit de l'écran pour voir les détails de l'état jaune. Si vous voyez une icône jaune à côté de **Not optimized (Non optimisé)**, vous devez optimiser votre détecteur.

◆ **Pour optimiser votre détecteur**

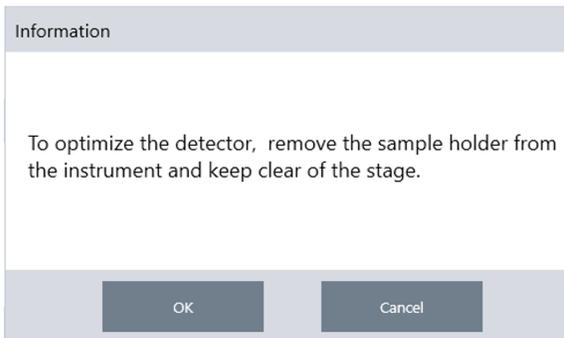
1. Sélectionnez **Acquire Data > Diagnostics > Optimize Detector (Acquisition > Diagnostic > Optimiser le détecteur)**.

Figure 3-12 : Le logiciel OMNIC Paradigm optimise la trajectoire du détecteur



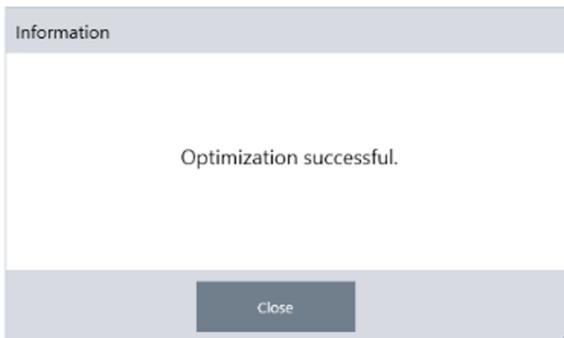
2. Suivez l'invite à l'écran et attendez que le processus soit terminé.

Figure 3-13 : Message contextuel d'optimisation du détecteur



Si l'état devient vert, vous avez réussi à optimiser votre détecteur.

Figure 3-14 : Message contextuel d'optimisation réussie



3.3 Analyse d'échantillons

Utilisez le logiciel OMNIC Paradigm pour faire fonctionner le microscope et analyser des échantillons. Généralement, vous analyserez votre échantillon selon les étapes suivantes :

- Préparation et chargement de l'échantillon.
- Capture d'une image visuelle de la surface de l'échantillon. Cette image est appelée mosaïque.
- Mesure d'un spectre de bruit de fond.
- Analyse de l'échantillon.

Avec le logiciel OMNIC Paradigm, vous pouvez configurer et utiliser le microscope avec des fonctions d'automatisation facilitant l'éclairage et la mise au point de l'échantillon, capturer une mosaïque et localiser un point de bruit de fond, ou faire fonctionner le microscope manuellement, sans automatisation, et inspecter visuellement votre échantillon avant de capturer toute image ou donnée visuelle.

Dans les deux cas, la première étape consiste à charger votre échantillon.

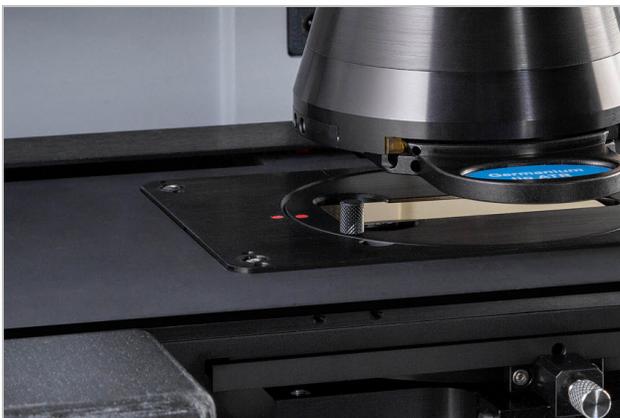
3.3.1 Chargement d'un échantillon

Éjectez la platine pour mieux y accéder et positionner votre échantillon. Si votre échantillon est petit et peut être facilement positionné, vous pouvez le positionner sans éjecter la platine.

◆ Pour insérer un échantillon

1. Dans le logiciel, cliquez sur **Eject Stage (Éjecter la platine)**. L'éjection de la platine abaisse la platine et la déplace vers l'extérieur pour faciliter le chargement d'un échantillon.
2. Insérez la lame à échantillon. La platine peut accueillir un porte-échantillon universel. Utilisez les indicateurs rouges pour orienter correctement le porte-échantillon.

Figure 3-1 : Insertion d'échantillons



Lorsque votre échantillon est installé, vous êtes prêt(e) à démarrer la session et à collecter une mosaïque.

Si vous avez éjecté la platine, celle-ci reviendra automatiquement à sa position d'origine lorsque vous démarrerez la session. Vous pouvez laisser la platine éjectée jusqu'au moment de démarrer la session.

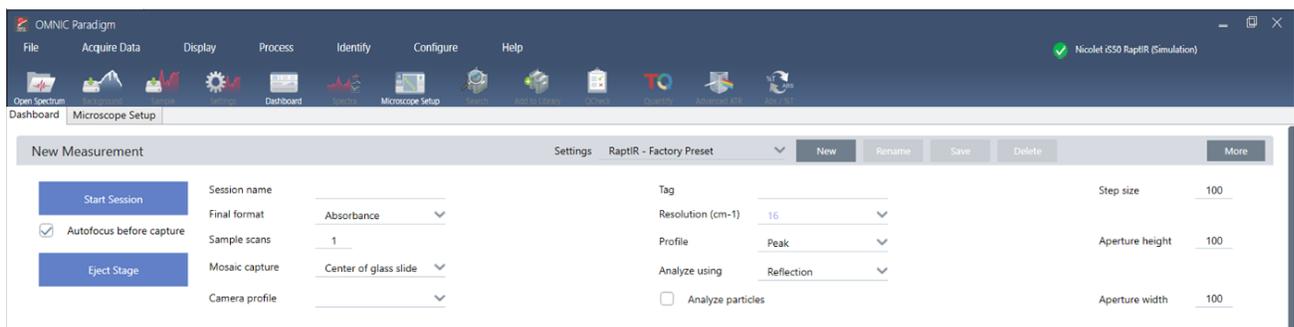
3.3.2 Préparation de vos paramètres de mesure

Une fois votre échantillon en place, vérifiez vos paramètres de mesure sur le tableau de bord. Les paramètres les plus utilisés sont affichés dans la partie supérieure et vous pouvez consulter des paramètres avancés supplémentaires en cliquant sur le bouton More (Plus).

Pour en savoir plus sur chacun des paramètres de mesure, reportez-vous au Manuel de l'utilisateur du logiciel OMNIC Paradigm.

- Pour simplifier votre session de microscopie en utilisant les fonctions d'automatisation, sélectionnez un type de mosaïque dans la liste Mosaic Capture (Capture de mosaïque), et sélectionnez Autofocus before capture (Mise au point auto avant capture). Si vous utilisez le porte-échantillon RaptIR, sélectionnez **Use the fixed reference location on the RaptIR sample holder (Utiliser l'emplacement de référence fixe sur le porte-échantillon RaptIR)** dans les paramètres de bruit de fond.
- Pour exécuter votre session manuellement, décochez l'option Autofocus before capture (Mise au point auto avant capture) et sélectionnez Custom Mosaic (Mosaïque personnalisée) dans la liste Mosaic Capture (Capture de mosaïque).

Figure 3-2 : Paramètre de la capture de mosaïque



Remarque Sélectionnez **Particle Analysis (Analyse de particules)** pour analyser des groupes de petites particules. Si cette option est sélectionnée, les outils d'analyse de particules seront présents dans la vue Session. Décochez la case Analyse de particules si vous souhaitez analyser des aires, des lignes et des points d'échantillonnage individuels.

Remarque Si vous utilisez l'objectif 40x avec la bague de mise au point manuelle, assurez-vous que la bague de mise au point est réglée sur la position 0. Une bague de mise au point mal positionnée peut interférer avec la mise au point automatique.

3.3.3 Vérification de vos paramètres de bruit de fond

Vérifiez vos paramètres de bruit de fond pour la collecte des données de bruit de fond avant d'entamer votre session.

BACKGROUND

Use the fixed reference location on the RaptIR sample holder

Match sample scans

Set background scans 16

Measure background before each region

Measure background once for entire sample

Tableau 3-1 : Paramètres de bruit de fond pour la microscopie

Paramètre	Description
Use the fixed reference location on the RaptIR sample holder (Utiliser l'emplacement de référence fixe sur le porte-échantillon RaptIR)	<p>Le porte-échantillon RaptIR possède des points de référence intégrés pour les analyses par transmission et par réflexion. Sélectionnez cette option pour déplacer automatiquement la platine vers l'emplacement de référence après avoir capturé votre mosaïque initiale.</p> <p>Cette option est indisponible si vous avez sélectionné Mosaïque personnalisée dans la liste Capture de mosaïque.</p> <p>Pour plus de détails, reportez-vous à Mesure d'un spectre de bruit de fond.</p>
Match sample scans (Correspondance des balayages d'échantillon)	<p>Si cette option est sélectionnée, le nombre de balayages utilisés pour la collecte du bruit de fond sera le même que le nombre de balayages utilisés pour la mesure de l'échantillon.</p>
Set background scans (Configurer les balayages d'échantillon)	<p>Sélectionnez cette option pour choisir un nombre de balayages pour la mesure du bruit de fond différent de celui pour la mesure de l'échantillon.</p>
Measure background before each region (Mesurer le bruit de fond avant chaque région)	<p>Si cette option est sélectionnée, le logiciel mesurera un nouveau bruit de fond avant le balayage de chaque nouvelle région de l'échantillon. Par exemple, si vous avez trois zones à mesurer dans l'échantillon, avec cette option sélectionnée, le logiciel collectera un nouveau bruit de fond avant la mesure de chaque aire.</p> <p>Notez qu'un ensemble de points qui utilisent les mêmes paramètres de mesure est considéré comme une seule région.</p>
Measure background once for entire sampler (Mesurer le bruit de fond une seule fois pour l'intégralité de l'échantillonneur)	<p>Lorsque cette option est sélectionnée, un nouveau bruit de fond est collecté uniquement lorsque les paramètres de mesure sont modifiés. Par exemple, une fois cette option sélectionnée, si vous mesurez trois zones dans une seule collecte d'échantillons et qu'elles utilisent toutes les mêmes paramètres de mesure, un seul bruit de fond est collecté.</p>

3.3.4 Capture d'une mosaïque

Lorsque votre échantillon est en place, capturez une mosaïque. Une mosaïque est une image visuelle de la surface de votre échantillon. La caméra capture une série de petites images à haute résolution et les assemble en une seule mosaïque, ce

qui génère une grande image de la surface de l'échantillon que vous pouvez utiliser pour votre analyse. La mosaïque fait office d'espace de travail pour votre analyse dans lequel vous pouvez explorer des régions d'intérêt et spécifier des aires et des points pour la collecte de vos données IR.

En général, lorsque vous analysez un échantillon, vous collectez une image mosaïque à faible grossissement avec un objectif 4x, ajustez vos paramètres selon les besoins puis, si nécessaire, capturez une mosaïque à fort grossissement d'une plus petite aire à l'aide de l'objectif 15x ou 30x. Lorsque vous avez capturé une mosaïque, dessinez des régions ou sélectionnez des particules puis commencez à mesurer des données.

Pour capturer une mosaïque, vous devrez vérifier vos paramètres de collecte, choisir un emplacement pour la capture de mosaïque et cliquer sur Start Session (Démarrer la session).

◆ Pour capturer une mosaïque

1. Sur le tableau de bord, sélectionnez **Autofocus before capture (Mise au point auto avant capture)** et vérifiez les paramètres de votre session. Lorsque vous sélectionnez cette option, le logiciel effectue automatiquement l'éclairage et la mise au point de l'échantillon. Décochez la case pour effectuer une mise au point manuelle.
2. Sélectionnez un emplacement dans la liste **Mosaic Capture (Capture de mosaïque)**. Ceci indique au logiciel où il peut trouver votre échantillon et à quel emplacement capturer la mosaïque. Pour démarrer la session sans collecter automatiquement de mosaïque, sélectionnez **Custom Mosaic (Mosaïque personnalisée)**.
3. Sélectionnez **Start Session (Démarrer la session)**.

La platine déplace votre échantillon à la position appropriée et procède à sa mise au point, et le logiciel collecte une mosaïque à faible grossissement, puis change d'objectif pour passer à l'objectif à grossissement élevé. Si vous avez sélectionné **Use the fixed reference location on the RaptIR sample holder (Utiliser l'emplacement de référence fixe sur le porte-échantillon RaptIR)**, le logiciel capture un instantané à grossissement, élevé, puis la platine se déplace automatiquement vers l'emplacement de référence pour collecter une mesure du bruit de fond.

Si vous avez sélectionné Mosaïque personnalisée depuis la liste Capture de mosaïque, le logiciel passe à la vue Session sans capturer de mosaïque.

3.3.5 Mesure d'un spectre de bruit de fond

Avant de collecter les données de l'échantillon, sélectionnez un spectre de bruit de fond.

Le porte-échantillon RaptIR possède des points de référence intégrés pour les mesures du bruit de fond. Si vous avez sélectionné l'option **Use the fixed reference location on the RaptIR sample holder (Utiliser l'emplacement de référence fixe sur le porte-échantillon RaptIR)**, la platine se déplace automatiquement vers l'emplacement de référence et prend un instantané de la mosaïque. Vous pouvez ensuite placer un point de bruit de fond comme d'habitude.

Figure 3-3 : Porte-échantillons



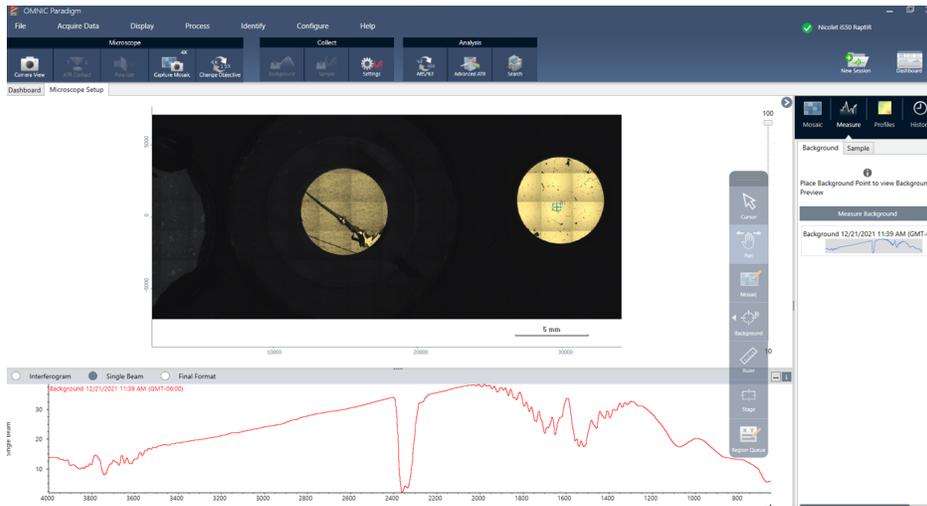
A Point de référence pour analyses par réflexion

B Point de référence pour analyses par transmission

◆ Pour mesurer un spectre de bruit de fond

1. Dans la barre d'outils flottante, sélectionnez l'outil **Background (Bruit de fond)**. 
2. Dans la mosaïque, cliquez sur l'emplacement où vous souhaitez mesurer le bruit de fond. Un spectre monofaisceau en direct s'affiche dans le panneau des spectres. Utilisez ce spectre pour déterminer si vous souhaitez utiliser ce point pour votre mesure du bruit de fond. Cliquez à nouveau sur la mosaïque pour déplacer le point de bruit de fond.
3. Si vous êtes satisfait(e) du point de bruit de fond, cliquez sur **Accept Background (Accepter le bruit de fond)**. Vous avez la possibilité de sélectionner un meilleur emplacement de bruit de fond avant de mesurer les données.
4. Cliquez sur **Measure Background (Mesurer le bruit de fond)**. Le spectre de bruit de fond est collecté. Une fois terminé, il est ajouté à l'onglet Background (Bruit de fond) de l'onglet Spectra (Spectres).

Figure 3-4 : Bruit de fond de la mosaïque



Si vous mesurez plusieurs aires sur une période donnée, remplacez votre mesure du bruit de fond régulièrement. En règle générale, il convient de toujours disposer d'une mesure récente du bruit de fond avant de mesurer l'échantillon.

3.3.6 Mesure des aires, des lignes et des points

Créez une image chimique d'une aire de la surface de l'échantillon en spécifiant une ou plusieurs régions à analyser. Vous pouvez également mesurer l'échantillon au niveau de points individuels en utilisant l'outil Point, ou mesurer le long d'une ligne à l'aide de l'outil Ligne. Vous pouvez mesurer des aires, des lignes et des points simultanément.

Pour mesurer des aires, des points et des lignes, vous devez d'abord capturer une mosaïque et mesurer le bruit de fond.

◆ Pour analyser des aires, des lignes et des points

1. Reportez-vous à la section [Capture d'une mosaïque](#).
2. Reportez-vous à la section [Mesure d'un spectre de bruit de fond](#).
3. Spécifiez les aires, les lignes et les points à analyser. Vous pouvez ajouter plusieurs aires et points à une seule analyse.

Pour analyser	Sélectionnez cet outil	Effectuez ces étapes
Aires		<ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez l'outil Area (Aire). 2. Cliquez sur la mosaïque et déplacez le curseur pour dessiner l'aire.

<p>Lignes</p> <p>(Non disponible lorsque vous utilisez le polariseur pendant la collecte de données IR)</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez l'outil Line (Ligne). 2. Cliquez et déplacez pour dessiner une ligne.
<p>Points</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez l'outil Point. 2. Cliquez pour ajouter un point.

Utilisez l'outil de curseur pour sélectionner ou supprimer des aires, des lignes et des points.

4. Lorsque vous avez terminé d'ajouter des régions et des points, cliquez sur **Sample (Échantillon)**.
5. Ouvrez la file d'attente des régions pour afficher et affiner les détails de tous les aires, lignes et points de votre mesure. Vous pouvez également sélectionner une mesure de bruit de fond à associer à chaque région.

Lorsque la mesure est terminée, visualisez les résultats dans le nouvel onglet.

Pour en savoir plus sur l'analyse et le partage de vos résultats, reportez-vous à [Étapes suivantes](#).

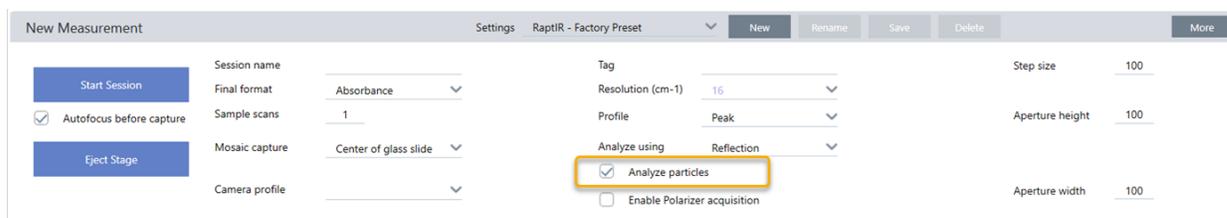
3.3.7 Analyse des particules

Utilisez les outils de Particle Analysis (Analyse des particules) pour localiser, caractériser et identifier des particules.

◆ Pour analyser des particules

1. Préparez votre échantillon.
2. Dans le tableau de bord, sélectionnez **Analyze particles (Analyse des particules)**.

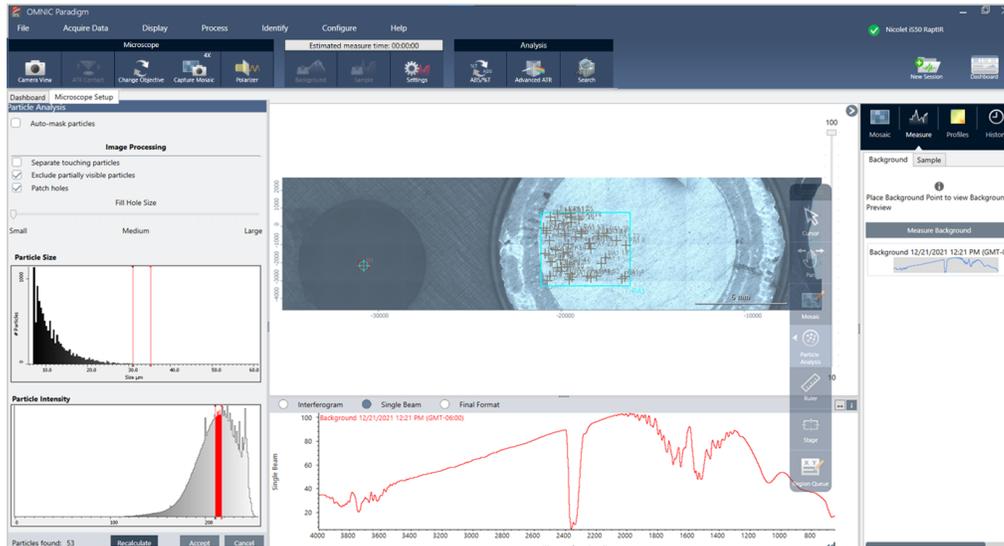
Figure 3-5 : Case à cocher Analyze particles (Analyse des particules)



3. [Capture d'une mosaïque](#).
4. Dans la vue Session, examinez la mosaïque et apportez toutes les modifications nécessaires à la mise au point et à l'éclairage. Capturez une mosaïque à fort grossissement si nécessaire.
5. [Mesure d'un spectre de bruit de fond](#).

6. Analysez les particules.
 - a. Sélectionnez l'outil Particle Analysis (Analyse de particules), puis cliquez et déplacez le curseur pour dessiner un rectangle sur la mosaïque. Il s'agit de la région d'intérêt dans laquelle le logiciel détectera des particules. Lorsque vous avez dessiné une région, le panneau Analyse de particules s'ouvre.

Figure 3-6 : Configuration de l'analyse des particules du logiciel OMNIC Paradigm



- b. Affinez votre sélection en utilisant les options et les outils de sélection. Sélectionnez **Recalculate (Recalculer)** après avoir mis à jour les paramètres pour mettre à jour les particules.

Reportez-vous aux guides et tutoriels du logiciel OMNIC Paradigm pour obtenir des explications détaillées sur les outils d'analyse de particules et les paramètres.

- c. Si vous êtes satisfait(e) de votre sélection, cliquez sur **Accept (Accepter)**. Cette action enregistre les paramètres de sélection, mais ne mesure pas encore les données.
 - d. Cliquez sur **Sample (Échantillon)**.
9. Lorsque la mesure est terminée, visualisez les résultats dans le nouvel onglet. Pour en savoir plus sur l'analyse et le partage de vos résultats, reportez-vous à [Étapes suivantes](#).

3.3.8 Étapes suivantes

- Application de profils pour visualiser les propriétés des données de l'échantillon
- Application de traitements aux spectres sélectionnés
- Création de rapports et exportation de données
- Explorez davantage le spectre dans la vue Spectra (Spectres).

3.4 Mesures ATR

Avec l'accessoire de réflectance totale atténuée (ATR) insérable en option, vous pouvez analyser des matériaux microscopiques absorbant fortement le rayonnement infrarouge ou difficiles à préparer, souvent avec peu voire pas de préparation de l'échantillon. Des exemples de ces matériaux incluent les polymères, les revêtements, les caoutchoucs, les papiers enduits et les matériaux biologiques.

Les applications de la microscopie ATR sont les suivantes :

- Analyse de la surface d'un échantillon.
- Analyse de matériaux fortement absorbants et de surfaces d'échantillons épais.
- Analyse de revêtements de surface.
- Analyse de défauts de surface, inclusions ou dégradation.

3.4.1 Installation de l'accessoire ATR insérable

L'accessoire ATR insérable s'installe dans l'objectif 15x et offre deux positions :

- Insertion à mi-course / jusqu'au premier point de butée pour visualiser l'échantillon à travers. Utilisez le mode caméra pour visualiser l'échantillon.
- Insertion complète jusqu'au deuxième point de butée pour l'ATR.

Un capteur sur le microscope détecte si l'accessoire ATR est installé, et le logiciel vous invite à l'installer ou à le retirer selon les besoins.

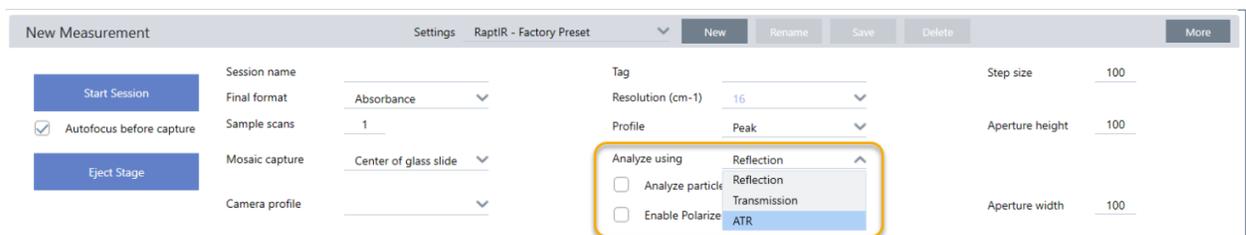
3.4.2 Mesure de données avec l'ATR

Pour utiliser l'accessoire de cristal ATR pour votre mesure, vous devez installer l'accessoire de cristal, préparer vos paramètres de mesure et mesurer l'échantillon.

◆ Pour mesurer en utilisant l'ATR

1. Sur le tableau de bord, sélectionnez **ATR** dans la liste **Analyze using (Analyser en utilisant)**.

Figure 3-1 : Analyser en utilisant : ATR



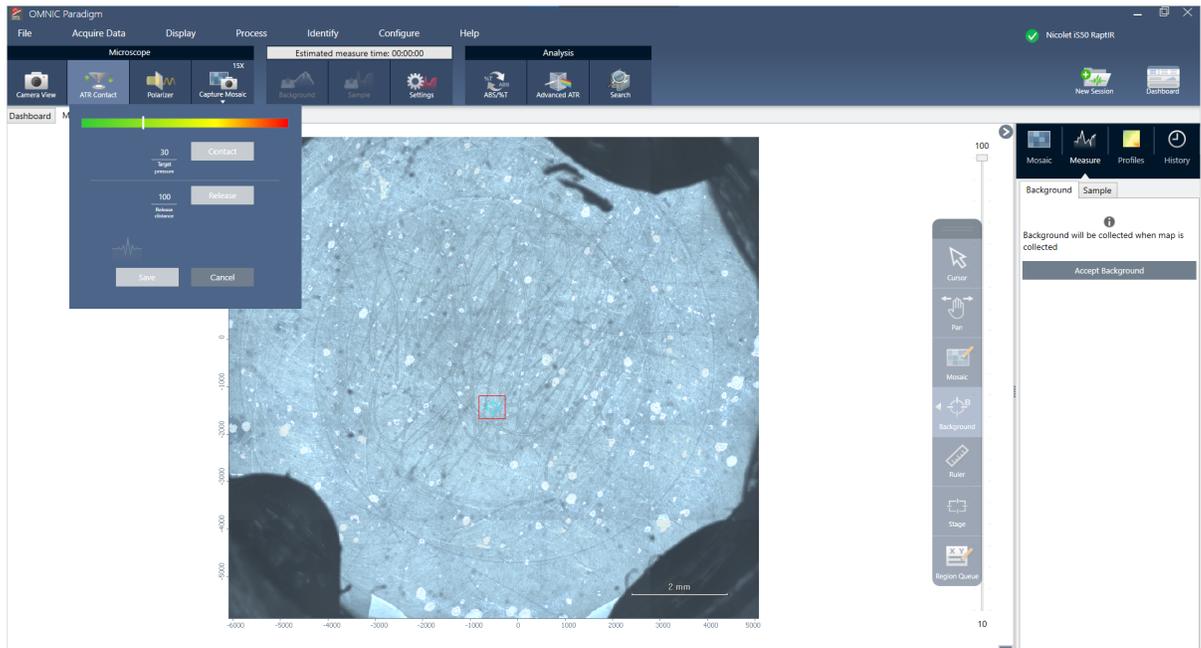
2. [Capture d'une mosaïque.](#)

Une fois que vous avez capturé une mosaïque, vous pouvez mesurer le bruit de fond avec le cristal installé et mesurer votre échantillon en utilisant les outils d'aire ou de point, de la même manière que pour une mesure par réflexion standard. En général, les paramètres par défaut de **ATR Contact (Contact ATR)** sont suffisants. Si vous souhaitez visualiser ou modifier les paramètres de contact, ouvrez la vue **ATR Contact (Contact ATR)** avant de mesurer le bruit de fond ou l'échantillon.

3. En option : passez en revue et modifiez les paramètres **ATR Contact (Contact ATR)**.

- a. Dans la vue Session, cliquez sur **ATR Contact (Contact ATR)** pour afficher les paramètres ATR.

Figure 3-2 : Contact ATR



Paramètre	Description
Target pressure (Pression cible)	Il s'agit de la pression cible qui sera appliquée pendant la mesure. Cliquez et déplacez le curseur ou saisissez une valeur exacte.
Release distance (Distance de libération)	La distance verticale sur laquelle se déplace la platine une fois que le contact ATR est libéré. Une plus grande distance offrira plus de dégagement, mais augmentera la durée de la mesure ATR étant donné que la platine s'éloignera davantage à chaque point.
Contact	Appuyez sur pour tester le contact.
Release (Libérer)	Appuyer pour libérer le contact.

- 4. Reportez-vous à la [Mesure des aires, des lignes et des points](#) ou à la [Analyse des particules](#). Le logiciel vous invite à insérer ou retirer l'accessoire de cristal ATR selon les besoins.

3.4.3 Vérification de la propreté de l'ATR

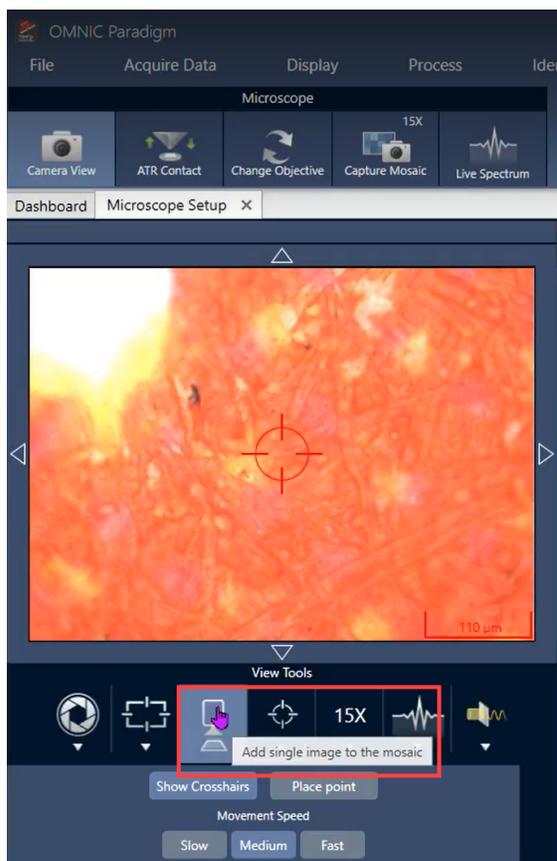
Exécution d'une "vérification de la propreté" manuelle dans le logiciel OMNIC Paradigm pour vérifier la propreté d'un cristal ATR après l'achèvement d'une expérience. Une comparaison est faite entre un échantillon propre et un échantillon contaminé, qui est capturée au moyen de pics dans les spectres. Étant donné qu'il s'agit d'un processus manuel, la vérification de la propreté de l'ATR implique certaines étapes nécessaires qui ne seraient pas normalement obligatoires. Une carte de visite texturée serait un échantillon idéal pour ce type de vérification.

Le processus comprend l'acquisition d'un spectre de votre échantillon, puis le relâchement de la pression (en relevant le cristal de l'échantillon) et la mesure d'un autre spectre. Si le cristal a été contaminé par l'échantillon, par exemple avec de l'huile ou un résidu adhésif, son spectre comprendra des pics résiduels. Cela nécessite ensuite de nettoyer le cristal.

◆ Pour exécuter une vérification de la propreté de l'ATR

1. Placez votre échantillon et définissez vos paramètres (**Analyze using (Analyser en utilisant)** doit être défini sur **ATR**).
2. Accédez à **Microscope Setup (Configuration du microscope)** et sélectionnez **Camera View (Vue de la caméra)**. Vous verrez une vidéo en direct de votre échantillon. (Ne lancez pas tout de suite une session).
3. Sélectionnez **Change Objective (Changer d'objectif)** pour le définir sur 15x.
4. Dans **View Tools (Afficher outils)**, sélectionnez l'icône du milieu, puis **Show Crosshairs (Afficher les réticules)** pour vous aider à voir votre cible.
5. Capturez une mosaïque à monocoup.

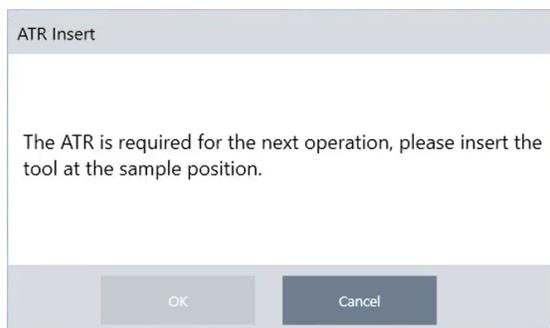
Figure 3-3 : Ajout d'une image unique à la mosaïque



6. Fermez la **Camera View (Vue de la caméra)** et accédez à **ATR Contact (Contact ATR)**.

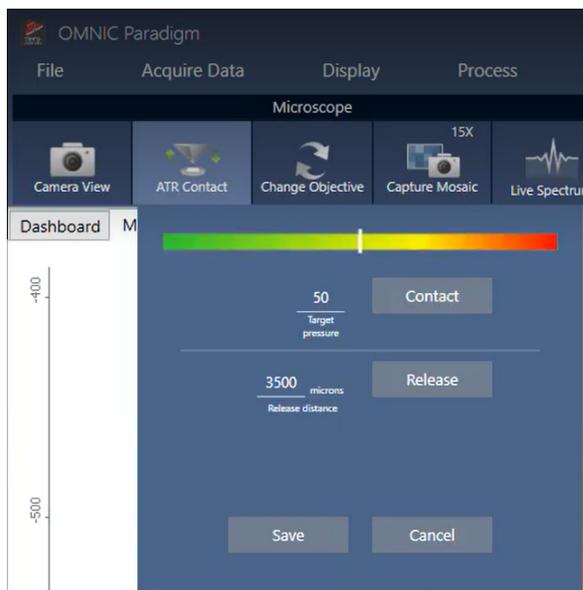
Remarque À ce stade, un message s'affiche si l'accessoire de cristal ATR n'est pas installé. Si c'est le cas, insérez simplement l'accessoire et sélectionnez **OK** (l'option sera indisponible tant que l'accessoire n'est pas inséré).

Figure 3-4 : Message contextuel concernant l'accessoire ATR



7. Dans le menu **ATR Contact (Contact ATR)**, définissez la target pressure (pression cible) et la release distance (distance de libération). Aux fins de la vérification, les paramètres suggérés sont une pression cible de 50 et une distance de libération de 3 500 microns, mais vous pouvez définir des valeurs différentes si vous le souhaitez. Une distance de libération importante permet de s'assurer que le cristal s'écarte de l'échantillon.

Figure 3-5 : Menu ATR Contact (Contact ATR) (définition de la pression cible)



8. [Mesure d'un spectre de bruit de fond](#). Cela est possible avec l'outil **Background (Bruit de fond)** dans la barre d'outils flottante.  Acceptez et mesurez le bruit de fond normalement, en sélectionnant **Accept Background (Accepter le bruit de fond)** et **Measure Background (Mesurer le bruit de fond)** dans le menu latéral.
9. Quand la mesure du bruit de fond est terminée, sélectionnez **Contact** dans le menu **ATR Contact (Contact ATR)** pour faire entrer en contact l'échantillon avec l'ATR. Cela ne déplace pas la platine ; le cristal ATR ne doit pas être en contact avec l'échantillon lors de l'acquisition du bruit de fond.
10. Sélectionnez **Measure Now (Mesurer maintenant)** pour mesurer le spectre.

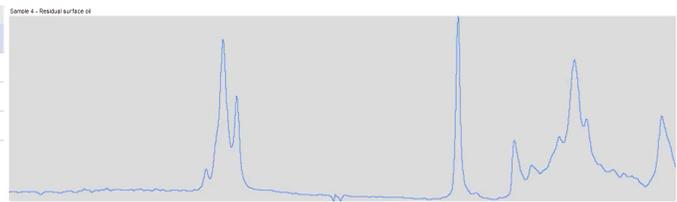
Remarque La fonction **Measure Now (Mesurer maintenant)** stocke vos données dans la section Measurements (Mesures) du tableau de bord du logiciel OMNIC Paradigm, où vous pouvez les charger et les passer en revue.

11. Sélectionnez **Release (Libérer)** dans le menu **ATR Contact (Contact ATR)** pour libérer le cristal, puis sélectionnez **Measure Now (Mesurer maintenant)** à nouveau pour obtenir une mesure du cristal lui-même.

Examinez le spectre du cristal libéré. Si des pics sont présents, cela indique qu'il a été contaminé par l'échantillon. Ici, de l'huile résiduelle est illustrée. Si le spectre est fondamentalement plat, vous pouvez continuer. Sinon, vous devez nettoyer le cristal avant de poursuivre.

Figure 3-6 : Échantillon avec huile résiduelle

Measurement Name	Last Modified	Type
Sample 4 - Residual surface oil	9/18/2023 11:23 AM	None
Sample 3 - Original with oil	9/18/2023 11:22 AM	None
Sample 2 - Clean spectrum	9/18/2023 11:21 AM	None
Sample 1 - Original	9/18/2023 11:20 AM	None



3.5 Émission sur le côté droit

Couplé à un spectromètre iS50, votre microscope peut être configuré pour l'opération d'émission sur le côté droit (RSE pour right side emission) avec une "synchronisation de passeport" et permettre à votre microscope d'analyser des échantillons d'émetteur.

ATTENTION



Évitez tout risque de lésions oculaires. La lumière émise par l'échantillon peut atteindre l'oculaire. Si votre échantillon émet une lumière dangereuse, prenez les précautions appropriées pour vous assurer que personne n'utilise l'oculaire pendant que l'échantillon émet de la lumière.

Remarque Avec cette méthode, l'émission sur le côté droit est réalisée du point de vue de votre spectromètre, au lieu du microscope.

Pour activer les mesures d'émission sur le côté droit, le microscope RaptIR doit être raccordé au côté droit d'un spectromètre Nicolet iS50, qui doit être équipé de l'option de synchronisation de passeport. Les données seront collectées à l'aide du détecteur de l'iS50, et non à l'aide du détecteur du microscope. À ce titre, cette configuration dirige le faisceau du microscope "en arrière" vers le spectromètre, où il sera modulé et détecté.

◆ Pour analyser avec l'émission sur le côté droit

1. Ouvrez le logiciel OMNIC Paradigm et sélectionnez **Connectivity > Nicolet iS50 (Connectivité > Nicolet iS50)** pour vous connecter au spectromètre. Ensuite, sélectionnez **Configure > Sample Location > Main Compartment (Configurer > Emplacement d'échantillon > Compartiment principal)**.
2. Sur le tableau de bord, définissez le réglage Source sur **Right collimated (Collimaté à droite)**. Cela ajustera les miroirs internes du spectromètre pour permettre au faisceau de se déplacer correctement pour l'émission sur le côté droit.
3. Utilisez la manette pour mettre au point et centrer votre échantillon. Pour changer d'objectif, sélectionnez **Camera View (Vue de la caméra)** dans la barre d'outils, puis sélectionnez l'objectif souhaité dans les commandes virtuelles.

Vous pouvez désormais mesurer vos données au besoin (reportez-vous à [Analyse d'échantillons](#)).

3.6 Localisation, éclairage et masquage de l'échantillon

Pour optimiser manuellement votre image mosaïque et vos données IR, utilisez la vue de la caméra pour identifier la région d'intérêt, faire la mise au point de l'échantillon, ajuster l'éclairage et modifier l'ouverture.

3.6.1 Déplacement de la platine et mise au point de l'échantillon

Le moyen le plus simple pour effectuer la mise au point de l'échantillon consiste à sélectionner un emplacement d'intérêt approximatif dans la liste Mosaic capture (Capture de mosaïque) et à sélectionner l'option Autofocus before capture (Mise au point auto avant capture). Une fois ces options sélectionnées, lorsque vous démarrez la session, la platine se déplace automatiquement à l'emplacement correct, effectue la mise au point de l'échantillon, et capture une mosaïque.

Si vous souhaitez la déplacer à un autre emplacement et effectuer la mise au point d'une nouvelle région, vous pouvez déplacer la platine et faire la mise au point de l'échantillon à l'aide du logiciel ou de la manette en option.

Déplacez la platine à l'aide du logiciel OMNIC Paradigm ou de la manette en option. N'essayez jamais de déplacer la platine à la main.

AVEC LE LOGICIEL

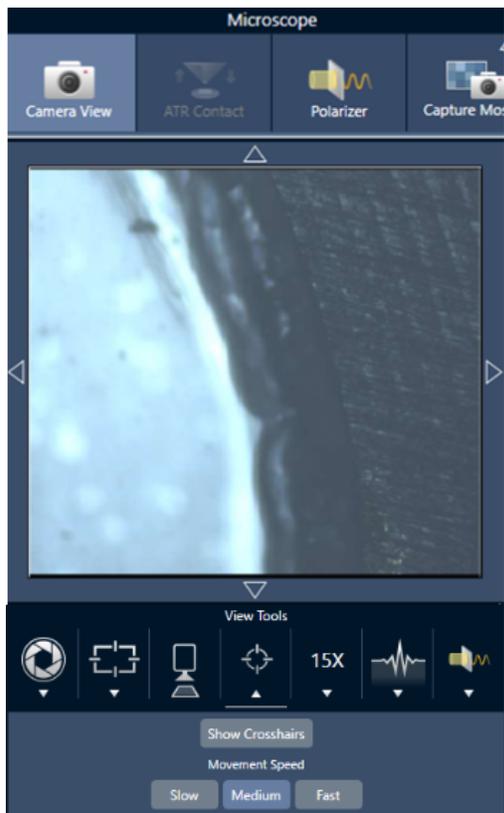
Dans la vue Session, ouvrez la vue de la caméra pour visualiser l'échantillon.

- **Pour déplacer la platine horizontalement**, ouvrez la Camera View (Vue de la caméra) et ouvrez les outils Stage (Platine).

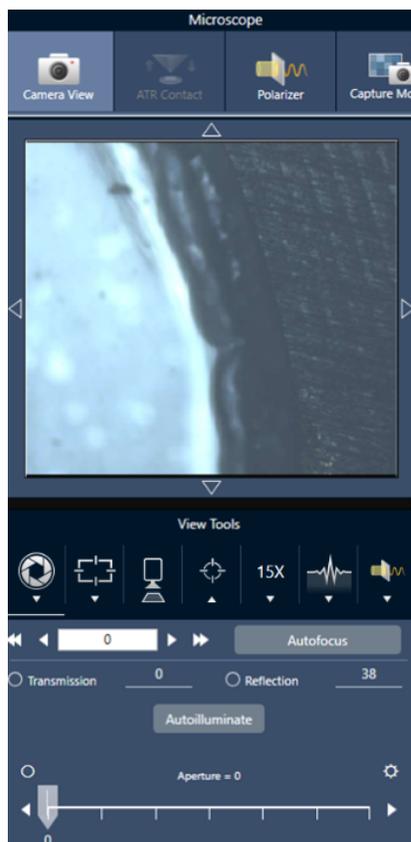
Cliquez sur les flèches situées sur les côtés, au-dessus et en dessous de l'image de l'échantillon pour déplacer la platine. Modifiez la vitesse du mouvement pour modifier la distance de déplacement de la platine à chaque clic.

Double-cliquez dans l'image vidéo en direct pour centrer la platine sur cette position.

Figure 3-1 : Outils de platine de la vue de la caméra



- **Pour déplacer la platine vers le haut et vers le bas**, ouvrez la Camera View (Vue de la caméra) et ouvrez les paramètres de mise au point. Cliquez sur les flèches gauche et droite pour déplacer la platine vers le haut ou vers le bas.

Figure 3-2 : Camera focus (Mise au point de la caméra)**Autofocus (Mise au point automatique)**

Pour effectuer la mise au point automatique de l'échantillon, cliquez sur Mise au point automatique. Le logiciel déplace la platine vers le haut et vers le bas pour trouver la mise au point optimale. La mise au point automatique fonctionne le mieux sur des zones à fort contraste visuel. La mise au point automatique peut être compliquée avec certains échantillons à faible contraste ainsi qu'avec des échantillons comportant plusieurs plans focaux.

Conseils pour la mise au point automatique

- Ajustez l'éclairage pour une visualisation optimale. Si l'éclairage est trop important ou trop faible, le contraste peut être insuffisant pour que la mise au point automatique effectue la mise au point appropriée.
- Si vous utilisez l'objectif 40x avec la bague de mise au point manuelle, assurez-vous que la bague de mise au point est réglée sur la position 0. Une bague de mise au point mal positionnée peut interférer avec la mise au point automatique.

AVEC LA MANETTE

Vous pouvez déplacer la platine horizontalement ou verticalement à l'aide de la manette et, avec la commande de vitesse du mouvement, vous pouvez la déplacer rapidement ou avec plus de précision. Utilisez la Vue de la caméra ou les oculaires en option pour évaluer votre position.

3. Fonctionnement

- **Pour déplacer la platine horizontalement**, poussez ou tirez la manette vers l'avant, l'arrière, la gauche et la droite.
- **Pour déplacer la platine vers le haut ou vers le bas**, tournez la manette dans le sens horaire pour déplacer la platine vers le haut ou dans le sens antihoraire pour la déplacer vers le bas.

Utilisez le sélecteur de vitesse pour modifier la vitesse du mouvement.

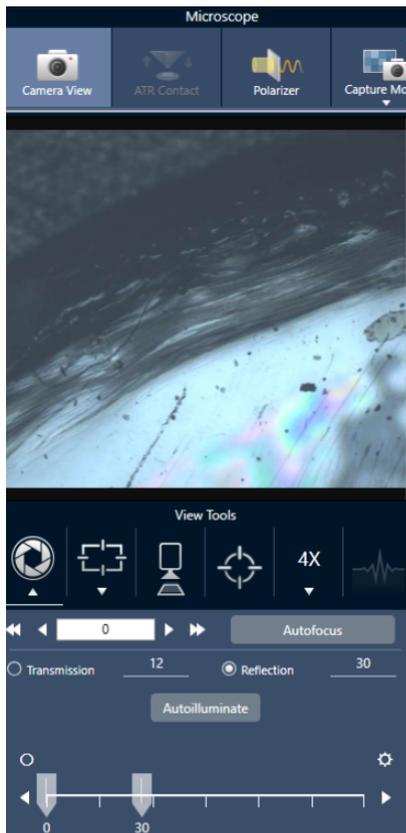
3.6.2 Éclairage de l'échantillon

Vous pouvez contrôler la quantité de lumière qui atteint l'échantillon en utilisant le logiciel ou la manette en option. Utilisez les commandes d'éclairage par réflexion pour que la lumière éclaire l'échantillon par le dessus et les commandes d'éclairage par transmission pour que la lumière éclaire l'échantillon par le dessous.

Avec le logiciel

Pour contrôler l'éclairage dans le logiciel, ouvrez la Vue de la caméra. Sélectionnez **Transmission** ou **Reflection (Réflexion)** et déplacez le curseur jusqu'au réglage d'éclairage souhaité. Vous pouvez également saisir une valeur exacte.

Figure 3-1 : Vue de la caméra (éclairage)



Illumination auto

Cliquez sur Illumination auto pour que le logiciel optimise automatiquement l'éclairage de l'échantillon.

Avec la manette en option

La manette en option comporte deux boutons de commande pour régler l'éclairage par transmission et par réflexion. Utilisez la Vue de la caméra ou les oculaires en option pour visualiser l'éclairage de l'échantillon. Tournez les boutons pour contrôler l'éclairage.

3.6.3 Réglage de l'ouverture

L'ouverture réglable définit la surface où le faisceau IR interagit avec l'échantillon. Ceci permet de s'assurer que l'énergie IR n'est appliquée qu'à la région d'intérêt et non au matériel de l'échantillon adjacent. Ceci garantit également que la faible quantité de rayonnement diffracté qui passe autour du bord de la zone d'intérêt n'atteint pas le détecteur.

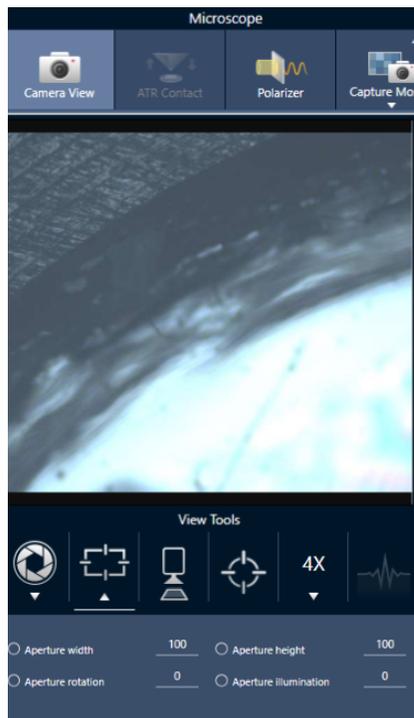
Pendant l'analyse de particules, le logiciel identifie un ensemble d'ouvertures idéales pour toutes les particules, puis utilise ces ouvertures pendant la mesure de l'échantillon.

Réglez l'ouverture manuellement dans la zone des paramètres avancés du tableau de bord ou dans la Vue de la caméra.

◆ Pour régler la taille, la forme et la rotation de l'ouverture

1. Ouvrez la Vue de la caméra et sélectionnez les paramètres d'ouverture.

Figure 3-1 : Vue de la caméra (paramètres d'ouverture)



2. Utilisez les curseurs ou saisissez une valeur exacte pour régler la hauteur, la largeur et la rotation de l'ouverture.

Remarque Pour visualiser l'ouverture, réglez l'éclairage jusqu'à voir le rectangle de lumière bleu clair qui passe à travers l'ouverture.

3.7 Vérification de la performance du microscope

Assurez-vous que votre microscope fonctionne correctement en exécutant des flux de travail de vérification de la performance (VP) et en vérifiant l'état du système.

3.7.1 Flux de travail de vérification de la performance et de qualification

Vérifiez la performance de votre microscope en exécutant les flux de travail de qualification ou de vérification de la performance (VP). Ces flux de travail utilisent un échantillon standard établi pour vérifier la performance de l'instrument. Chaque test suit différentes normes réglementaires.

Les flux de travail de VP et de qualification utilisent la plaque d'étalons en polystyrène pour tester la performance du microscope.

Tableau 3-1 : Descriptions des flux de travail de qualification et de vérification de la performance

Test	Description
Nicolet RaptIR - Factory Qualification (Qualification d'usine)	Exécute les tests recommandés en usine et tous les tests de qualification.
Nicolet RaptIR - Factory ATR Qualification (Qualification ATR d'usine)	Exécute les tests recommandés en usine et tous les tests de qualification en utilisant l'accessoire ATR.
Nicolet RaptIR - PV Test (Test PV)	Mesure les performances de base du microscope RaptIR en se basant sur les tests recommandés en usine.
Nicolet RaptIR - PV ATR Test (Test ATR PV)	En utilisant l'ATR, mesure les performances de base du microscope RaptIR en se basant sur les tests recommandés en usine.
Nicolet RaptIR - PHEUR Qualification (Qualification PHEUR)	Exécute les tests de qualification pour le microscope RaptIR tels que définis dans la Pharmacopée européenne.
Nicolet RaptIR - PHEUR ATR Qualification (Qualification ATR PHEUR)	Exécute les tests de qualification pour l'accessoire ATR sur le microscope RaptIR tels que définis dans la Pharmacopée européenne.
Nicolet RaptIR - USP Qualification (Qualification USP)	Exécute les tests de qualification pour le microscope RaptIR tels que définis dans la Pharmacopée des États-Unis.
Nicolet RaptIR - JP Qualification (Qualification JP)	Exécute les tests de qualification pour le microscope RaptIR tels que définis dans la Pharmacopée du Japon.
Nicolet RaptIR - CP Qualification (Qualification CP)	Exécute les tests de qualification pour le microscope RaptIR tels que définis dans la Pharmacopée chinoise.

◆ **Pour exécuter un flux de travail de qualification ou de vérification de la performance**

1. Cliquez avec le bouton droit sur le flux de travail et sélectionnez **Run (Exécuter)**.
2. Suivez les invites à l'écran.

Une fois le flux de travail terminé, les rapports finaux sont ajoutés au panneau Rapports dans le tableau de bord et peuvent être imprimés.

3.7.2 État du système

L'icône d'état du système affiche des informations sur votre instrument et les services logiciels.



Tableau 3-2 : Icônes d'état du système

Icône	Icône avec Security Suite installé	Description
		Le système est connecté et tous les services fonctionnent correctement. Vous êtes prêt(e) à mesurer et à enregistrer des données. Cliquez sur l'icône d'état du système pour afficher les détails relatifs au système.
		<p>Une icône jaune signifie qu'il peut y avoir un problème avec l'instrument, par exemple :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le détecteur est chaud • L'instrument n'effectue pas de balayage • L'instrument n'est pas connecté <p>Cliquez sur l'icône d'état du système pour obtenir plus de détails sur le problème. Inspectez également visuellement l'instrument et la connexion.</p>
		Un ou plusieurs services logiciels rencontrent un problème. Cliquez sur l'icône d'état du système pour obtenir plus de détails. Si le service ne démarre pas automatiquement au bout de quelques minutes, redémarrez l'ordinateur.

Si vous continuez de rencontrer des problèmes d'erreurs d'état du système, contactez l'assistance clientèle.

3.8 Utilisation du polariseur

Les microscopes avec l'option Polariseur comprennent des polariseurs séparés pour la lumière visible et pour la lumière infrarouge.

Pour chaque source de lumière, le microscope comprend deux filtres polarisants, appelés "polariseur" et "analyseur".

- **Polariseur** : positionné entre la source de lumière et l'échantillon
- **Analyseur** : positionné entre l'échantillon et la caméra ou les oculaires et le détecteur

Lorsque vous utilisez le polariseur, vous pouvez insérer le polariseur seul, pour une lumière avec polarisation plane, ou le polariseur et l'analyseur, pour obtenir une lumière avec polarisation croisée. Il est possible de faire pivoter le polariseur et l'analyseur ensemble ou indépendamment.

3.8.1 Utilisation du polariseur et de l'analyseur

Pour utiliser les polariseurs, commencez par regarder l'échantillon dans la vue de la caméra. Dans cette vue, vous pouvez utiliser le polariseur de lumière visible et prévisualiser les réglages du polariseur pour les données spectrales. Le polariseur ne peut pas être utilisé pendant l'analyse des particules ou lors de la mesure des lignes. Il peut être utilisé pour mesurer des aires et des points.

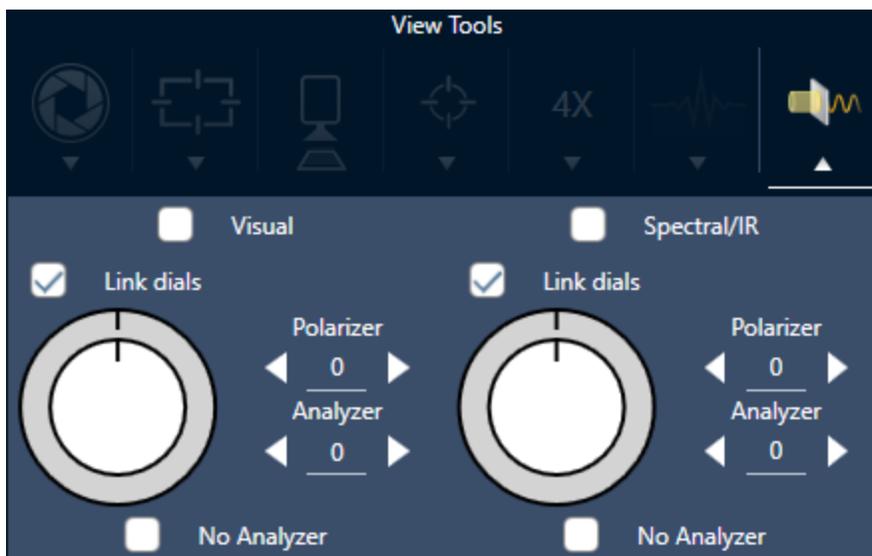
◆ Pour utiliser le polariseur et l'analyseur dans la vue de la caméra

1. Sur le tableau de bord, sélectionnez **Enable Polarizer acquisition (Activer l'acquisition du polariseur)**.

Lorsque cette option est sélectionnée, les régions sont mesurées à l'aide du polariseur. Si vous ne modifiez aucun paramètre, les paramètres par défaut du polariseur et de l'analyseur sont utilisés. Vous pouvez changer d'avis pendant la session et activer ou désactiver le polariseur avant de collecter les données.

2. Commencez votre session de microscopie comme d'habitude.
3. Dans la vue Configuration de la microscopie, ouvrez la vue de la caméra et accédez à l'onglet Polariseur.

Figure 3-1 : L'onglet Polarizer (Polariseur) dans la vue de la caméra



4. Sélectionnez **Visual (Visuel)** pour utiliser le polariseur de lumière visible. Sélectionnez **Spectral / IR** pour utiliser le polariseur IR.
 - Visualisez l'image d'exemple dans la vue de la caméra pendant que vous ajustez les paramètres du polariseur de lumière visible.
 - Pour obtenir un aperçu des réglages du polariseur IR, activez la vue Live Spectra (Spectres en direct) et visualisez le spectre.

Prévisualisation des images polarisées et des données IR dans la vue de la caméra

Tableau 1. Réglages du polariseur dans Vue de la caméra

Paramètre	Description
Visual (Visuel)	Sélectionnez cette option pour activer le polariseur visuel.
Spectral / IR	Sélectionnez pour activer le polariseur IR
Link dials (Lier les boutons)	Si cette option est sélectionnée, la vitesse de rotation du polariseur et de l'analyseur est identique. Le fait de changer l'angle de l'un change également l'autre.
Polarizer angle (Angle du polariseur)	Permet de régler l'angle du polariseur.
Analyzer angle (Angle de l'analyseur)	Permet de régler l'angle de l'analyseur.

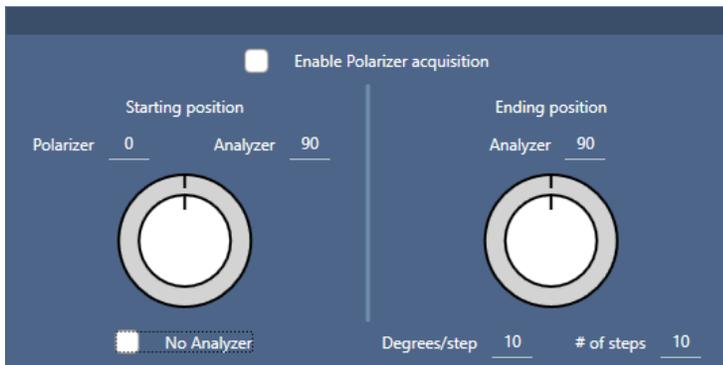
Paramètre	Description
No analyzer (Aucun analyseur)	Si cette option est sélectionnée, l'analyseur est retiré du trajet du faisceau, et seul le polariseur est utilisé.

3.8.2 Collecte de données IR avec le polariseur

Lorsque vous mesurez votre échantillon avec le polariseur activé, vous pouvez effectuer la mesure de deux façons :

- Mesure de la région entière du polariseur (et de l'analyseur, éventuellement) à un angle unique et fixe.
- Faites tourner automatiquement l'analyseur pendant la mesure et collectez les données à un intervalle spécifié - par exemple, tous les 5 degrés de rotation.

Figure 3-2 : Options de configuration du polariseur



◆ Pour collecter des données avec le polariseur et l'analyseur

1. Dans la vue Configuration de la microscopie, cliquez sur Configuration du polariseur dans la barre d'outils pour afficher les paramètres du polariseur.
2. Sélectionnez **Enable Polarizer acquisition (Activer l'acquisition du polariseur)**.
3. Modifiez et révissez les réglages de votre polariseur.
 - Pour utiliser un seul angle fixe, réglez le nombre d'étapes sur 1. Seule la position de départ de l'analyseur est utilisée.
 - Pour une collection échelonnée...
 - a. Permet de régler l'angle du polariseur.
 - b. Définissez les angles de départ et d'arrivée des analyseurs.

- c. Définissez soit le **# of steps (nombre de pas)**, soit les **Degrees/step (degrés par pas)**. L'autre paramètre est mis à jour automatiquement.

4. Définissez une ou plusieurs régions et mesurez l'échantillon comme d'habitude.

Le point du bruit de fond est automatiquement mesuré à chaque angle de l'analyseur pour correspondre à l'échantillon. Lors de la collecte des échantillons, chaque région est mesurée sous tous les angles spécifiés.

Figure 3-3 : Paramètres d'acquisition du polariseur

Paramètre	Description
Enable Polarizer acquisition (Activer l'acquisition du polariseur)	Sélectionnez cette option pour utiliser le polariseur (et éventuellement l'analyseur) pendant la collecte des données.
Starting position (Position de départ)	Polarizer (Polariseur) : angle fixe du polariseur. Analyzer (Analyseur) : angle de départ de l'analyseur. Si le nombre d'étapes est réglé sur 1, c'est le seul angle utilisé.
No analyzer (Aucun analyseur)	Sélectionnez cette option pour retirer l'analyseur du trajet du faisceau et utiliser uniquement le polariseur.
Ending position (Position de fin)	Analyzer (Analyseur) : l'angle d'arrivée de l'analyseur. Degrees/step (degrés par pas) : saisissez les degrés par pas ou le nombre de pas. L'autre valeur est calculée automatiquement. # of steps (Nombre de pas) : saisissez les degrés par pas ou le nombre de pas. L'autre valeur est calculée automatiquement.

3.8.3 Exploration des données polarisées

Après avoir collecté des données avec le polariseur, les résultats sont affichés dans l'onglet Analyse. Lorsque vous visualisez des données recueillies avec un polariseur, vous pouvez utiliser le curseur d'angle pour visualiser l'image de profil à chaque angle utilisé dans la collecte.

3.9 Mesure de données de point unique

Remarque La mesure de données de point unique n'est pas disponible pour le mode ATR dans la version 2.3 ou inférieure du logiciel OMNIC Paradigm.

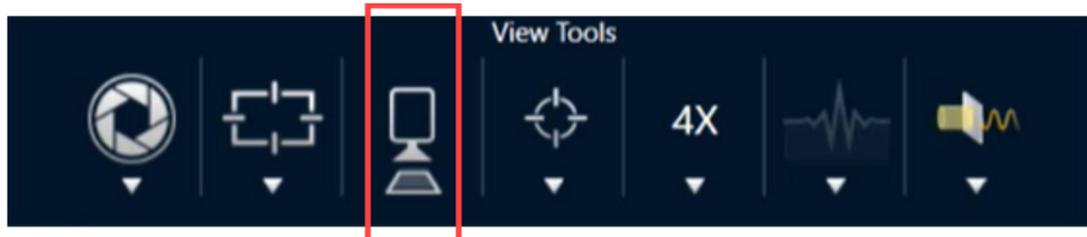
Vous pouvez utiliser le bouton Measure Now (Mesurer maintenant) dans le logiciel OMNIC Paradigm pour mesurer les données au point actuellement affiché dans la vue de la caméra en direct. La nouvelle mesure est automatiquement ajoutée à la liste des mesures de votre tableau de bord.

Il n'est pas nécessaire d'utiliser le bouton Start Session (Démarrer la session) pour mesurer des données de point unique. Au lieu de cela, configurez votre session comme d'habitude et accédez à l'onglet Microscope Setup (Configuration du microscope).

◆ Pour mesurer les données de point unique

1. Sélectionnez **Camera View (Vue de la caméra)** et centrez votre échantillon, en utilisant la manette ou l'oculaire, ou en utilisant une mosaïque précédemment capturée.
2. Sélectionnez l'**icône d'image unique** dans le menu **View Tools (Afficher outils)** pour collecter une mosaïque à monocoupe à l'aide d'un objectif 4x.

Figure 3-1 : Icône d'image unique.



3. Sélectionnez **Change Objective (Changer d'objectif)** pour passer à l'objectif 15x.

Figure 3-2 : Changer d'objectif (15x)

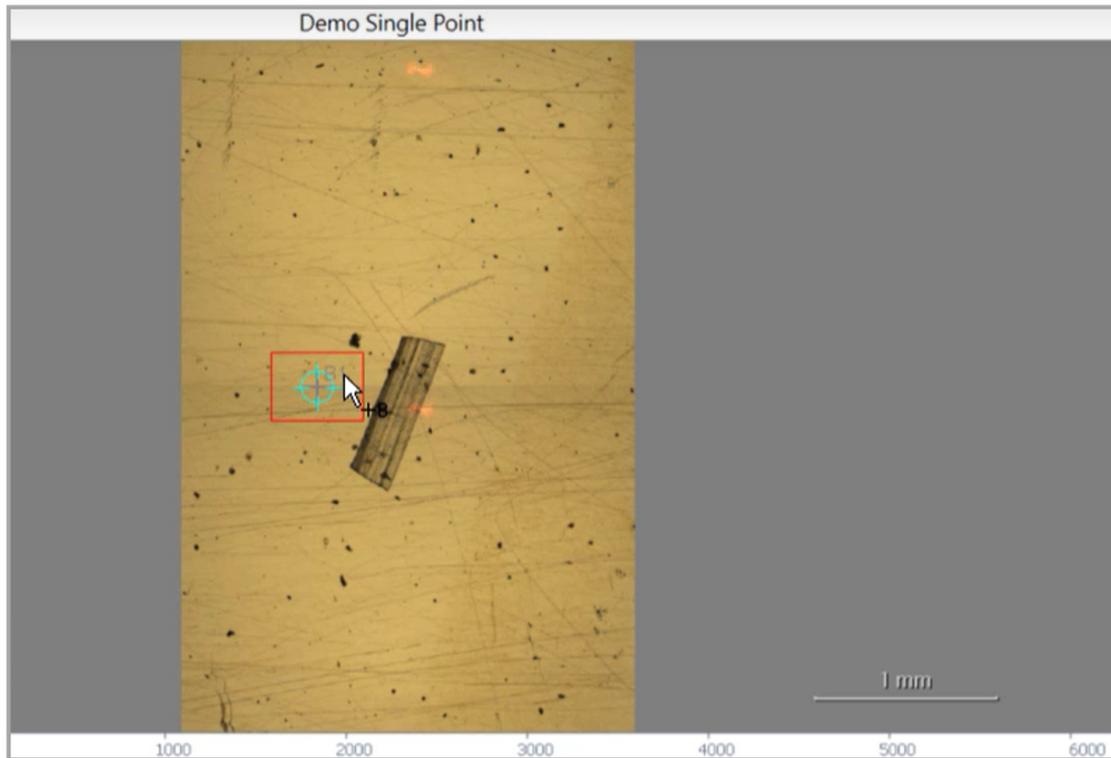


4. Cliquez sur le bouton **Background (Bruit de fond)**.



En utilisant la mesure de point unique, le logiciel établit n'importe quel point d'arrière-plan centré sur un réticule.

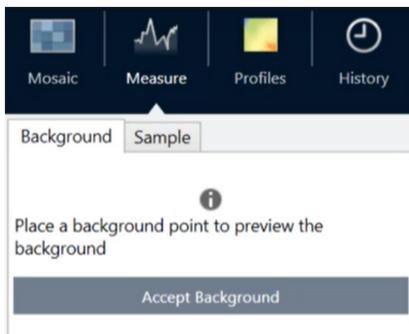
Figure 3-3 : Bruit de fond de point unique



Vous pouvez librement déplacer la caméra et cliquer sur l'écran pour placer ou déplacer le point d'arrière-plan souhaité.

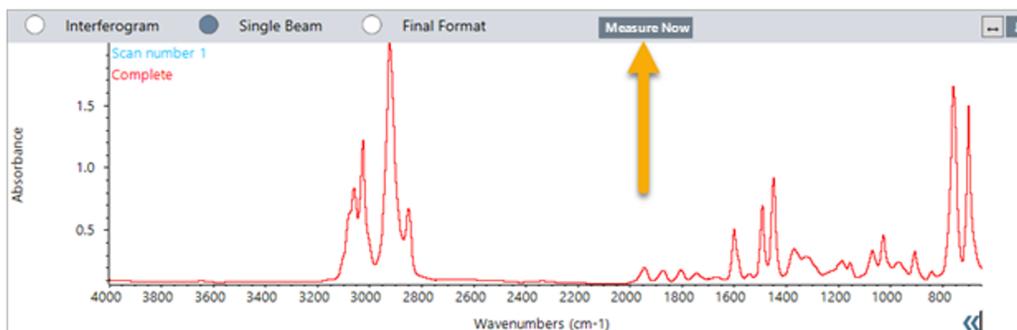
Lorsque vous êtes prêt, sélectionnez **Accept Background (Accepter le bruit de fond)**.

Figure 3-4 : Bouton Accept Background (Accepter le bruit de fond)



5. Sélectionnez **Measure Background (Mesurer le bruit de fond)** et attendez la fin de la mesure.
6. Déplacez la vue de votre caméra sur votre échantillon. Vous pouvez le faire en utilisant les flèches de la vue de la caméra.
7. Sélectionnez **Measure Now (Mesurer maintenant)** pour mesurer vos données de l'échantillon.

Figure 3-5 : Bouton Measure Now (Mesurer maintenant)



Remarque

Problèmes connus du logiciel OMNIC Paradigm v2.3 :

- Le logiciel affiche tous les résultats de chaque numérisation sous la forme d'une pile de 10. Le résultat marqué "Complete" (Complété) est le bon.
- Les données mesurées ne sont stockées ni sous la mesure ni sous la session. En tant que tel, essayer de rouvrir à nouveau la même session ne produit aucune donnée. Les données doivent être accessibles directement.

3.10 Utilisation de l'objectif à angle d'incidence (en option)

L'objectif à angle d'incidence (GAO) est un ajout optionnel installé en usine pour le microscope RaptIR+ qui permet l'analyse d'échantillons de films ultraminces sur des surfaces réfléchissantes. L'utilisation du GAO est similaire à l'utilisation d'autres objectifs IR, mais diffère de plusieurs manières en raison de sa conception spécialisée.

AVIS

En raison de sa profondeur de champ plus étroite, vous devez toujours mettre l'échantillon au point manuellement lorsque vous utilisez le GAO, et vous ne devez jamais utiliser la fonction **Autofocus (Mise au point automatique)**.

AVIS

L'objectif à angle d'incidence est très serré, de sorte que la tête du miroir doit être plus proche de l'échantillon que la normale. Ce manque de place est correct et attendu, mais amène un risque de raclage de l'échantillon lors du déplacement de la platine. Veillez à ne pas cogner l'objectif sur l'échantillon lors du prélèvement.

AVIS

Vous n'avez pas besoin d'utiliser l'illuminateur lorsque vous travaillez avec l'objectif GAO. L'éclairage supplémentaire n'est pas nécessaire et le câble peut s'emmêler avec l'objectif pendant la rotation.

◆ Collecte de données avec le GAO

AVIS

L'objectif à angle d'incidence interfère avec l'insertion du module complémentaire de diapositive ATR. Pour fonctionner avec la glissière ATR, dévissez l'objectif GAO et assurez-vous de ne pas dévisser la bague d'alignement supérieure de l'ensemble GAO, car elle est alignée pour un bon fonctionnement du GAO. Pour réutiliser le GAO, revissez simplement l'objectif en place.

1. [Chargement d'un échantillon](#). Dans le tableau de bord, définissez **Analyse using (Analyser en utilisant)** sur **Reflection (Réflexion)**.

Le GAO fonctionne mieux avec des revêtements ultrafins sur des surfaces réfléchissantes, comme un miroir en or.

2. [Préparation de vos paramètres de mesure](#).

Avant de sélectionner **Start Session (Démarrer la session)** ou d'accéder à la vue du microscope, démarrez la session normalement, mais ignorez l'étape de mise au point automatique à tous les points et effectuez la mise au point manuellement. N'utilisez jamais la mise au point automatique lorsque vous utilisez le GAO.

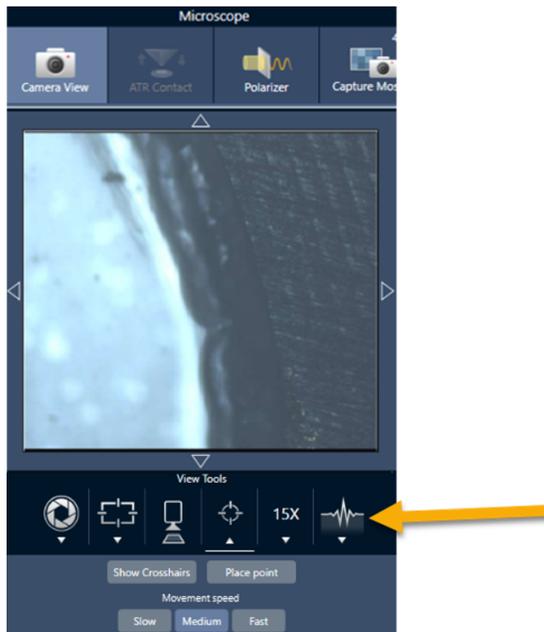
3. [Capture d'une mosaïque](#).

Démarrez votre session normalement. Récupérez une mosaïque 4x, puis une mosaïque 15x si nécessaire.

4. Dans la barre d'outils, sélectionnez **Change Objective (Changer d'objectif)** pour passer à l'objectif à angle d'incidence.

5. Modifiez la mise au point du GAO. Avec le logiciel ou la manette en option, utilisez des mouvements fins pour régler la hauteur de la scène.
 - Ouvrez **Camera View (Vue de la caméra)** et sélectionnez l'onglet Live Spectra (Spectres en direct) sous View Tools (Afficher outils).

Figure 3-1 : Spectres en direct de la vue de la caméra



- Utilisez le signal IR pour déterminer quand l'échantillon est mis au point.
6. [Mesure d'un spectre de bruit de fond.](#)
 7. [Mesure des aires, des lignes et des points.](#)

Récupérez votre échantillon comme d'habitude.

AVIS

Veillez à ne pas cogner l'objectif sur l'échantillon lors de la mesure. L'échantillonnage de grandes zones ou de points particulièrement éloignés augmente ce risque.

Lorsque vous terminez une session, l'objectif passe automatiquement à l'objectif 4x. Pour éviter le risque de collision entre l'objectif et l'échantillon lors de la rotation, déplacez la platine vers le bas avant de terminer la session.

3.11 Contraste d'interférence différentielle (en option)

Votre microscope peut être configuré avec des capacités de contraste d'interférence différentielle (DIC).

Le DIC est une technique optique qui utilise des prismes de Wollaston et des polariseurs croisés pour améliorer le contraste et la visibilité dans des échantillons autrement transparents, tels que des stratifiés en couches, des échantillons biologiques non colorés ou certains polymères.

L'exécution du DIC n'est possible que si votre microscope a été spécifiquement configuré avec cette capacité par Thermo Fisher Scientific. Pour de plus amples informations, [contactez-nous](#).

Remarque La technique de DIC ne peut être utilisée qu'en mode Transmission. De plus, l'optique de DIC ne fonctionne qu'avec l'objectif et le condenseur visible IR 15x.

◆ Pour effectuer un DIC

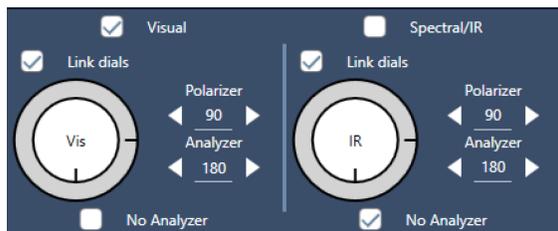
1. Illuminez et mettez au point un échantillon, puis capturez une mosaïque 15x. Pour plus d'informations, consultez les sections [Déplacement de la platine et mise au point de l'échantillon](#) et [Capture d'une mosaïque](#). Lorsque la réflexion et l'image du condenseur sont correctement focalisées, la vue affiche une lumière vive.

Remarque Vous pouvez utiliser l'iris manuel sur le côté inférieur droit du microscope. Lorsque le condenseur est à la bonne mise au point, les bords de l'iris apparaissent nets.

2. Sélectionnez la fonction polariseur à l'extrémité droite du menu Camera View (Vue de la caméra). Activez le polariseur visuel et assurez-vous que la case **No Analyzer (Aucun analyseur)** en bas n'est pas cochée (vous aurez besoin de l'analyseur). Réglez le polariseur à 90° et l'analyseur à 180°.

La vue de la caméra doit s'assombrir, indiquant que les polariseurs ont été croisés à un angle de 90°. Assurez-vous de cocher la case **Link dials (Lier les boutons)** pour vous assurer qu'ils restent liés. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Utilisation du polariseur](#).

Figure 3-1 : Paramètres DIC pour le polariseur dans la vue de la caméra



3. Placez délicatement le premier prisme de Wollaston dans la fente inférieure près de la base de votre appareil.

Le prisme peut nécessiter une pression ferme pour s'insérer. Il doit être bien ajusté et aller jusqu'au bout jusqu'à ce qu'il y ait une résistance.

Figure 3-2 : Insérez le prisme de Wollaston dans la fente de la base



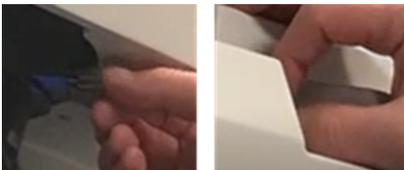
4. Desserrez la vis moletée de l'embout nasal du microscope. Cela permettra au deuxième prisme de Wollaston de glisser au-delà des indentations. Faites glisser le prisme dans le nez (côté encoche vers le haut) jusqu'à ce qu'il s'arrête, puis fixez le prisme en serrant doucement la vis moletée.

Figure 3-3 : Insérez le prisme de Wollaston dans la fente de la partie nasale



5. L'insertion de l'optique de DIC dans le microscope assombrit l'image de votre échantillon. Pour y remédier, augmentez l'éclairage dans le logiciel (le niveau 5 est recommandé).
6. Utilisez vos doigts pour faire pivoter les prismes de Wollaston et manipuler l'image de l'échantillon. Cela entraîne des changements de couleur visibles pour vous donner une meilleure visibilité de votre échantillon avec un effet tridimensionnel. Vous pouvez également enregistrer des mosaïques ou des captures d'image unique de l'image résultante.

Figure 3-4 : Rotation des prismes de Wollaston



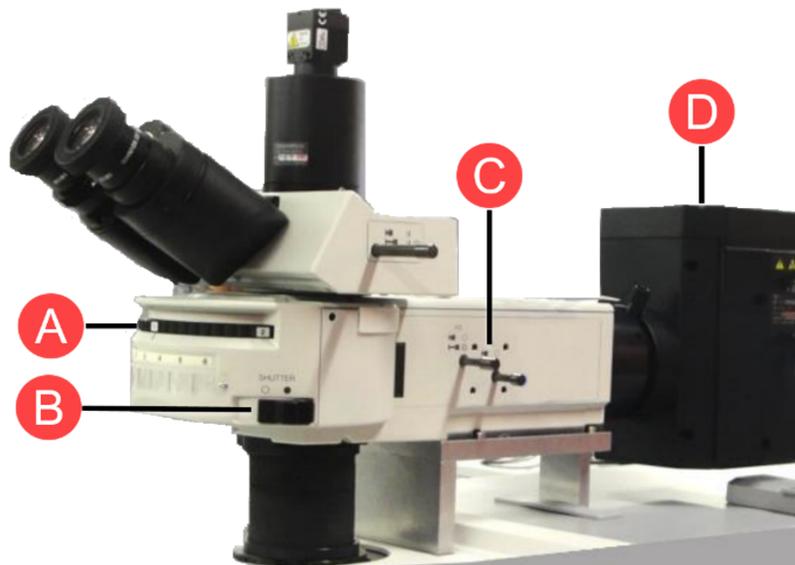
3.12 Illuminateur de fluorescence (en option)

Votre microscope est compatible avec un illuminateur de fluorescence conçu pour localiser et éclairer les parties d'un échantillon fluorescent qui présentent un intérêt.

Remarque L'illuminateur de fluorescence doit être utilisé pour localiser les points d'intérêt dans un échantillon. Il n'est pas utilisé pour collecter ou mesurer des données.

L'illuminateur de fluorescence peut être installé par un représentant Thermo Fisher. Pour de plus amples informations, [contactez-nous](#).

Figure 3-1 : Illuminateur de fluorescence RaptIR



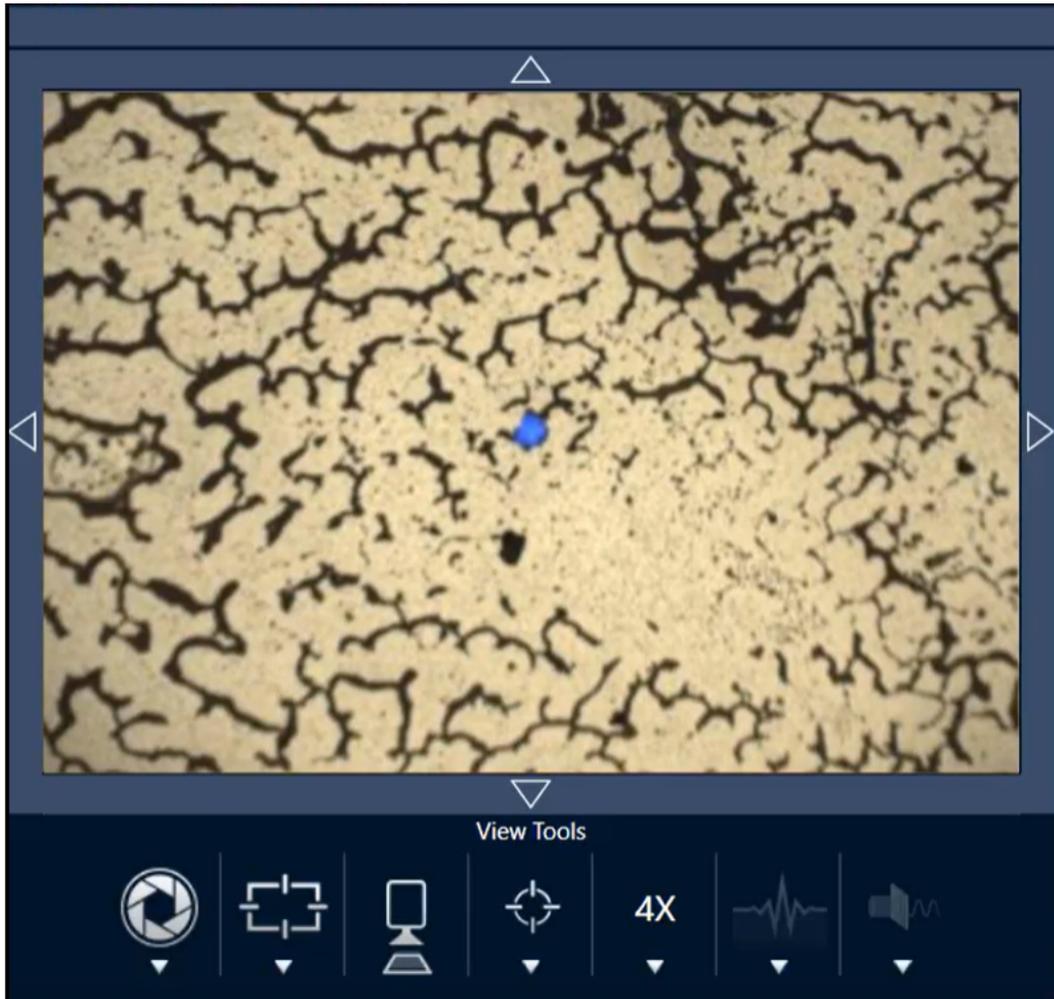
A	Monture rotative : utilisée pour passer à différentes fréquences d'éclairage si nécessaire.
B	Obturbateur : allumer ou éteindre pour bloquer la lumière ou la laisser passer.
C	Éléments optiques et ouvertures : peuvent également être utilisés pour manipuler le flux de lumière.
D	Lampe d'éclairage : positionnée près de l'arrière de l'instrument.

◆ Pour éclairer votre échantillon avec l'illuminateur de fluorescence

1. Centrez votre échantillon à l'aide de la vue de microscopie du logiciel OMNIC Paradigm.

Commencez avec un objectif 4x à vitesse moyenne de la manette pour une vue plus large. Cela vous permet de trouver plus facilement les emplacements fluorescents de l'échantillon.

Figure 3-2 : Échantillon centré (billes de polystyrène fluorescentes colorées) à l'aide d'un objectif 4x et d'une excitation bleue. Une perle apparaît fluorescente.



2. Une fois que vous avez centré votre cible, sélectionnez **Change Objective (Changer d'objectif)** pour passer à l'objectif 15x. Vous verrez une image beaucoup plus lumineuse de votre échantillon et des points d'intérêt.

Figure 3-3 : Option de changement d'objectif 15x



3. Concentrez-vous sur l'échantillon si nécessaire. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Déplacement de la platine et mise au point de l'échantillon](#).

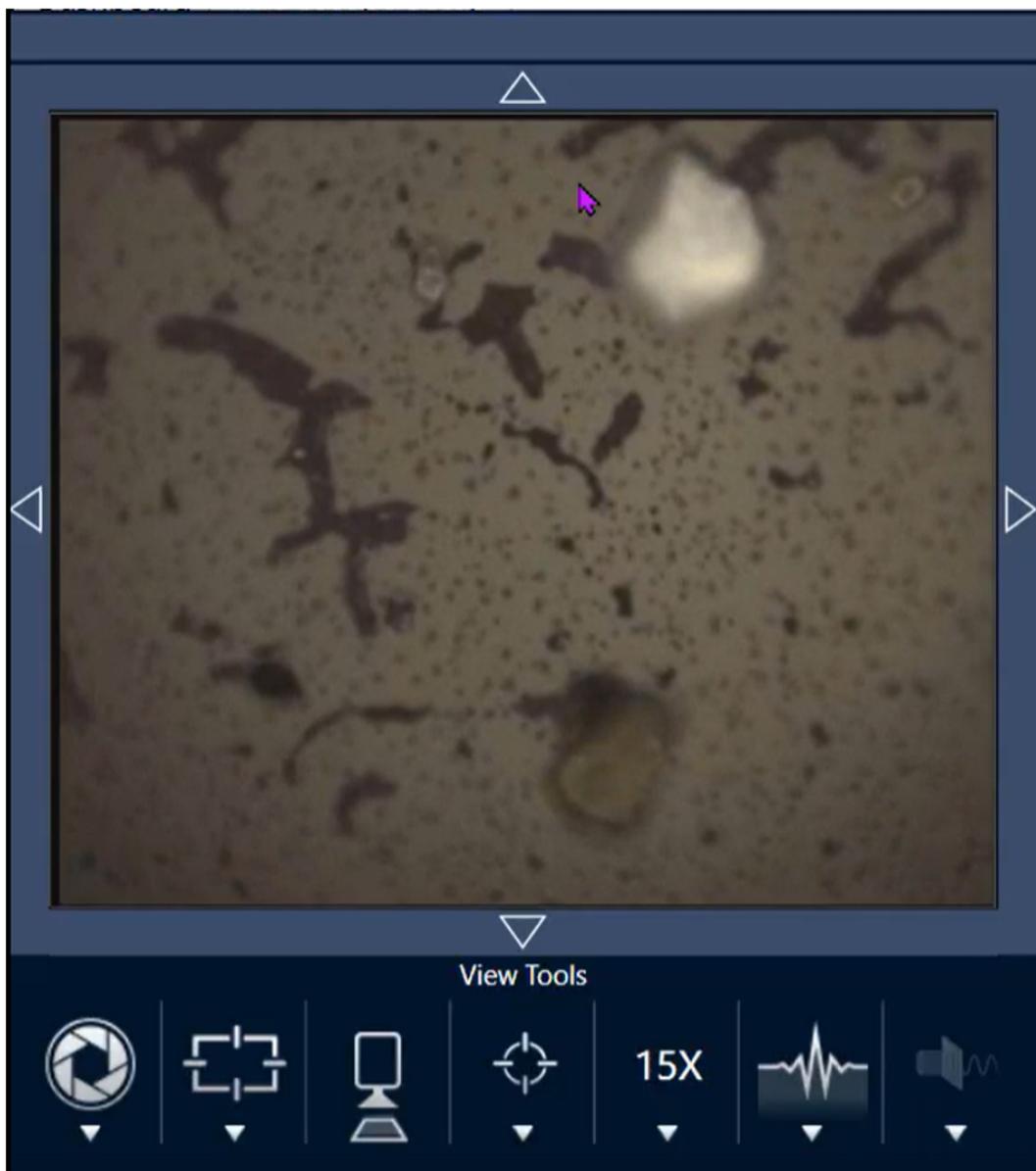
Figure 3-4 : Échantillon centré (billes de polystyrène teintées) à l'aide d'un objectif 15x.



La perle de l'exemple est maintenant beaucoup plus brillante. Aucune modification n'a été apportée à l'éclairage par fluorescence. Une deuxième perle à proximité est également visible maintenant.

4. Fermez l'obturateur (arrêt de la fluorescence) lorsque vous êtes prêt à mesurer les données. À ce stade, vous pouvez utiliser l'illuminateur régulier du microscope.

Figure 3-5 : Billes de polystyrène teintées à l'aide d'un objectif 15x (obturateur fermé)



3.13 Utilisation de la platine Linkam en mode Transmission

Votre microscope prend en charge l'utilisation d'une platine Linkam pour vous permettre d'analyser des échantillons dans une chambre climatique. Dans cette configuration, la platine de positionnement standard est retirée et la platine Linkam est installée directement sur le support en queue d'aronde.

AVIS

Avant de commencer vos manipulations, attendez trois à cinq minutes pour permettre au LVDT de s'initialiser après la mise sous tension du microscope.

Remarque Cette configuration est fixe et ne permet pas à la platine de se déplacer sur l'axe x-y.

3.13.1 Insertion et retrait de la platine Linkam

La configuration de platine Linkam est installée et assemblée par un représentant de Thermo Fisher, mais vous pouvez la retirer et la réinsérer au besoin pour changer de platine. Si vous ne trouvez pas réponse à vos questions dans ces instructions, contactez-nous.

◆ Pour insérer la platine Linkam

1. Retirez la platine standard si elle est actuellement montée. (Reportez-vous à la section [Insertion et retrait de la platine standard.](#))
2. Assurez-vous que la platine Linkam est posée bien à plat sur le support en queue d'aronde et alignez les broches d'alignement sur le dessous de la platine avec les trous du support, puis appuyez. Si la platine est correctement alignée, elle se clipse avec un minimum de force.
3. Resserrez le bouton avant fermement avec votre main pour fixer la platine.

Figure 3-1 : Bouton avant de la platine



4. Configurez la platine Linkam. Accédez à **Configure > Instrument > Microscope (Configurer > Instrument > Microscope)** et sélectionnez **RaptIR with Manual Stage (RaptIR avec platine manuelle)**. Ensuite, redémarrez le logiciel OMNIC Paradigm.

Figure 3-2 : Option Microscope du logiciel OMNIC Paradigm

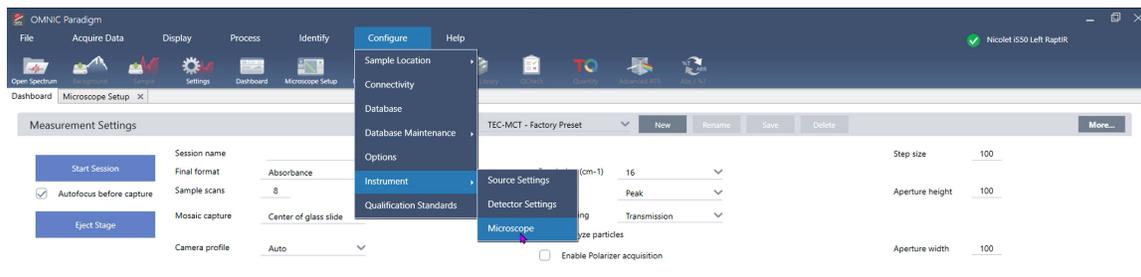
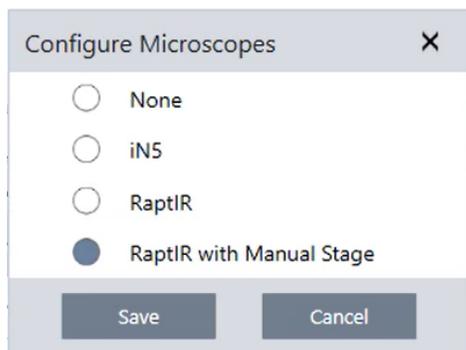


Figure 3-3 : Configure Microscopes (Configurer les microscopes) - option manual stage (platine manuelle)



◆ Pour retirer la platine Linkam

1. Depuis le tableau de bord du logiciel OMNIC Paradigm, définissez **Analyze using (Analyser en utilisant)** sur **Reflection (Réflexion)** ou **ATR**. Cela abaisse le condenseur et vous laisse l'espace nécessaire pour retirer la platine.

Figure 3-4 : Condenseur remonté

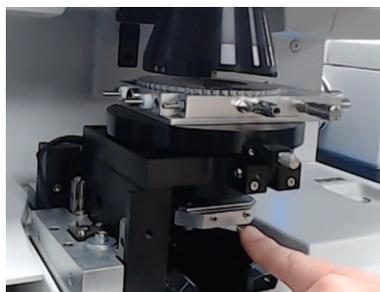


Figure 3-5 : Condenseur abaissé



2. Desserrez le bouton avant avec votre main (dans le sens antihoraire).

Figure 3-6 : Bouton avant de la platine



3. Retirez la platine Linkam. Si elle est suffisamment desserrée, elle devrait se déclipser en faisant un bruit. Si vous n'arrivez pas à retirer la platine, desserrez simplement le bouton un peu plus.

Figure 3-7 : Retrait de la platine Linkam



Pour protéger au mieux votre platine Linkam quand vous ne l'utilisez pas, stockez-la dans un emplacement sûr dans son emballage d'origine, si vous l'avez encore. Vous pouvez laisser l'anneau de montage dessus.

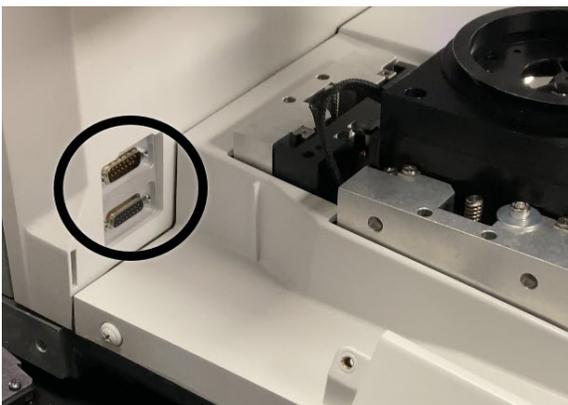
3.13.2 Insertion et retrait de la platine standard

Vous pouvez réinstaller la platine RaptIR+ standard au besoin quand vous ne devez pas utiliser la platine Linkam.

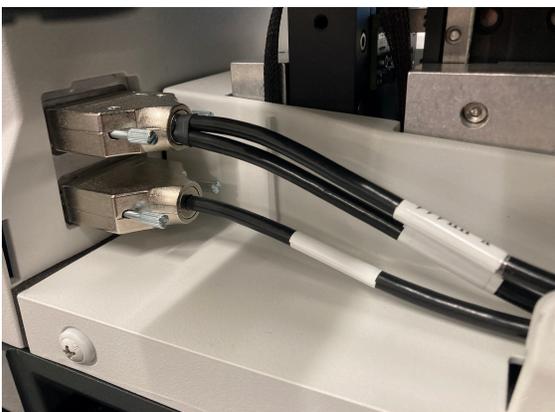
◆ Pour insérer la platine standard

1. Utilisez un tournevis cruciforme pour ouvrir le couvercle latéral de votre microscope.

Figure 3-8 : Retrait du couvercle latéral



2. Une fois le couvercle retiré, branchez les câbles de la platine standard. Les câbles et les connecteurs sont mâles et femelles, ils ne peuvent donc pas être intervertis. Une fois qu'ils sont branchés, utilisez un petit tournevis plat pour visser les vis de réglage des câbles. Ne serrez pas de manière excessive.



3. Fonctionnement

3. Prenez la platine standard et alignez-la avec le support en queue d'aronde (assurez-vous que le bouton avant de la platine est correctement desserré), puis appuyez dessus. La platine se clipsera.
4. Fixez la platine en serrant fermement le bouton avant, jusqu'à ce qu'il soit totalement serré.
5. Pour configurer la platine standard, accédez à **Configure > Instrument > Microscope (Configurer > Instrument > Microscope)** et sélectionnez **RaptIR**.

Fermez et redémarrez le logiciel OMNIC Paradigm.

Figure 3-9 : Option Microscope du logiciel OMNIC Paradigm

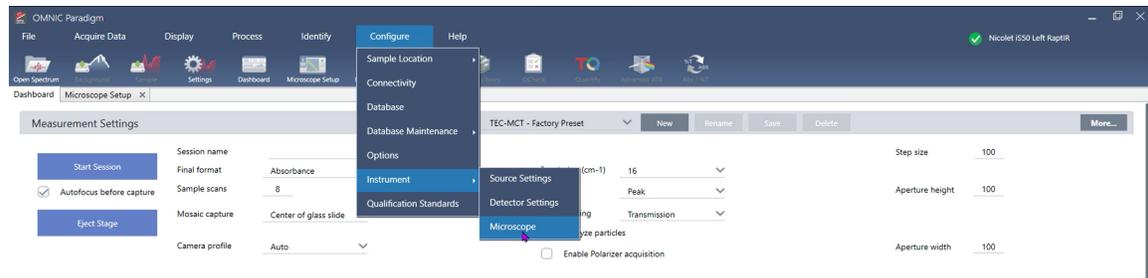
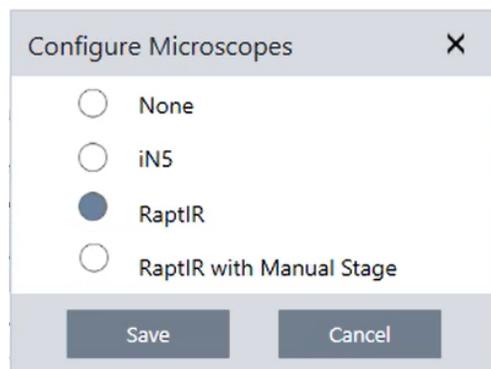


Figure 3-10 : Configure Microscopes (Configurer les microscopes) - option RaptIR



Si la platine est correctement installée et configurée, le logiciel vous demande si vous souhaitez l'initialiser. Sélectionnez OK pour poursuivre le fonctionnement normal.

Pour retirer la platine, suivez simplement les étapes physiques ci-dessus dans l'ordre inverse ou reportez-vous à la section ci-dessous.

◆ Pour retirer la platine standard

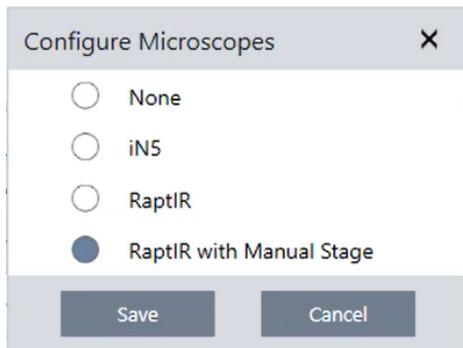
1. Dévissez les vis de réglage des câbles du connecteur.
2. Débranchez les câbles du connecteur.
3. Desserrez le bouton avant de la platine standard.
4. Retirez la platine standard en la tirant vers le haut. Si vous n'arrivez pas à retirer la platine, desserrez simplement le bouton un peu plus.

3.13.3 Utilisation de la platine Linkam

Cette section décrit comment configurer une mesure en mode Transmission avec la platine Linkam et le logiciel OMNIC Paradigm.

1. Assurez-vous que la platine est configurée. Si ce n'est pas le cas, accédez à **Configure > Instrument > Microscope (Configurer > Instrument > Microscope)** et sélectionnez **RaptIR with Manual Stage (RaptIR avec platine manuelle)**.

Figure 3-11 : Message Configure Microscopes (Configurer les microscopes)



2. Utilisez le bouton de la platine pour ajuster l'anneau du porte-échantillon et le rapprocher du centre.
3. Définissez **Analyze using (Analyser en utilisant)** sur **Transmission**.

Remarque Si le condenseur est physiquement tout en haut, vous pouvez temporairement définir **Analyze using (Analyser en utilisant)** sur **ATR** pour l'abaisser, et pouvoir déplacer la platine. Assurez-vous de revenir en mode **Transmission** après cela.

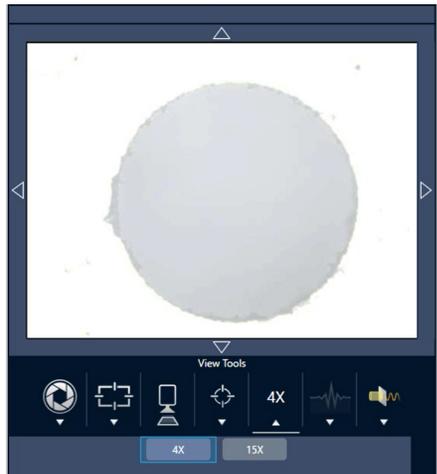
4. Accédez à **Microscope Setup (Configuration du microscope)** et sélectionnez **Camera View (Vue de la caméra)**.
5. Réglez votre objectif sur 4x.
6. Utilisez la manette pour augmenter l'éclairage et relever la platine. (Vous pouvez également le faire avec les commandes virtuelles dans la Microscope View [Vue du microscope]). Effectuez ces ajustements jusqu'à voir l'image mise au point dans la Camera View (Vue de la caméra).

Vous voyez une image nette du trou et de l'anneau du porte-échantillon. Retirez l'anneau du porte-échantillon du champ de vision pour voir clairement le trou.

Figure 3-12 : Trou avec l'anneau du porte-échantillon



Figure 3-13 : Image nette du trou



Remarque À ce stade, n'utilisez pas les commandes de l'axe z, car vous perdriez la mise au point de l'image.

7. Passez à l'objectif 15x. L'écran devient noir.
8. Sélectionnez l'option **Condenser (Condenseur)** et définissez-la sur environ **40 000**. Vous verrez de la lumière provenant du dispositif d'éclairage de Transmission.
9. Baissez complètement le dispositif d'éclairage Reflectance (Réflexion).
10. Fermez légèrement l'iris à l'aide du bouton de commande inférieur de l'iris à droite de la platine. Les bords de l'iris indiquent quand la mise au point est effectuée. Assurez-vous d'utiliser le bouton inférieur de l'iris, et pas le bouton supérieur.
11. Mettez au point l'image du condenseur jusqu'à ce que les bords de l'iris deviennent nets.

Figure 3-14 : Image mise au point du condenseur de l'iris



Remarque À ce stade, ne manipulez pas l'objectif et le condenseur.

12. Sélectionnez **Show Crosshairs (Afficher les réticules)** dans la Camera View (Vue de la caméra). Cette étape est facultative, mais elle indique l'emplacement précis où le système effectuera son analyse.
13. Accédez à **Live Spectrum (Spectre en direct)**.

Vous êtes maintenant prêt à insérer votre échantillon et à mesurer vos données comme à votre habitude.

Remarque Vous pouvez déplacer votre échantillon dans les directions x et y à l'aide des micromètres de la platine Linkam. N'ajustez *pas* l'emplacement Z, car le système perdrait la mise au point. Les options x et y de la manette n'auront pas d'effet.

[Page laissée intentionnellement blanche]

4. Maintenance

4.1 Nettoyage du microscope

Si vous souhaitez retirer de la poussière présente sur un miroir, une fenêtre ou un composant optique, éliminez-la à l'aide du souffleur de poussière fourni avec le microscope. N'utilisez pas d'air comprimé ou de chiffon à poussière au risque d'endommager l'instrument. Ne laissez jamais un liquide entrer en contact avec une fenêtre ou un composant optique.

4.2 Maintenance du vase de Dewar d'azote liquide

Le vase de Dewar du détecteur devrait maintenir son vide isolant pendant plusieurs années. Si le vide est perdu, l'isolation perdra de son efficacité et les symptômes suivants pourront apparaître :

- Temps de maintien et condensation raccourcis (l'azote liquide bout beaucoup plus rapidement que d'habitude)
- Condensation d'eau et de contaminants atmosphériques sur la fenêtre du détecteur qui apparaîtront dans les spectres sous forme de pics indésirables
- Notez que de la condensation d'eau peut également apparaître pendant le refroidissement normal du détecteur dans des environnements très humides

AVIS

Si votre instrument présente un de ces problèmes, il est possible que le vase de Dewar du détecteur présente une fuite de vide. Contactez-nous immédiatement pour obtenir de l'aide.

4.3 Stockage et expédition de votre détecteur

Votre détecteur peut se dégrader avec le temps, entraînant des problèmes de performances et la nécessité de pomper à nouveau le vase de Dewar.

Cette section comprend des instructions sur la façon de stocker et d'expédier votre détecteur à Thermo Fisher pour le repompage, l'entretien et la maintenance. Une recommandation générale est de faire repomper vos détecteurs tous les sept ans, bien que cela puisse varier en fonction de l'utilisation.

Les dispositifs de retenue d'expédition du détecteur doivent être réinstallés avant de stocker le détecteur pour l'expédition.

AVERTISSEMENT



Évitez tout danger. Assurez-vous que le vase de Dewar du détecteur est vide avant de réinstaller les dispositifs de retenue. N'essayez pas de retirer un détecteur ou de réinstaller les dispositifs de retenue s'il y a de l'azote liquide dans le vase de Dewar.

Remarque Si vous stockez simplement vos détecteurs sur une étagère et que vous ne prévoyez pas de les expédier à Thermo Fisher pour entretien, il n'est pas nécessaire de réinstaller les dispositifs de retenue d'expédition. Ne réinstallez les dispositifs de retenue que si vous prévoyez d'expédier vos détecteurs pour le pompage et l'entretien.

Si vous avez perdu les pièces de retenue d'expédition d'origine de votre détecteur, [contactez-nous](#) pour en commander de nouvelles.

◆ Pour réinstaller les pièces de retenue du détecteur

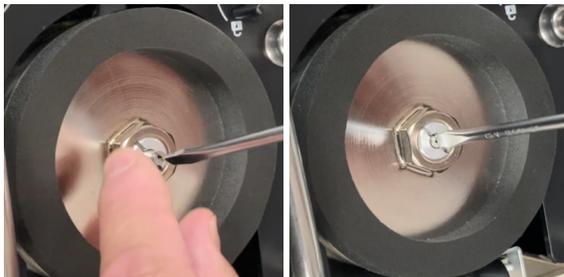
1. Insérez la plus grande pièce de retenue dans l'orifice de remplissage du vase de Dewar du détecteur et vissez-la jusqu'à ce qu'elle soit bien ajustée.

Figure 4-1 : Réinstallation de la plus grande pièce de retenue



2. Insérez la plus petite pièce de retenue d'expédition dans le trou et vissez-la jusqu'à ce qu'elle soit bien ajustée.

Figure 4-2 : Réinstallation de la plus petite pièce de retenue



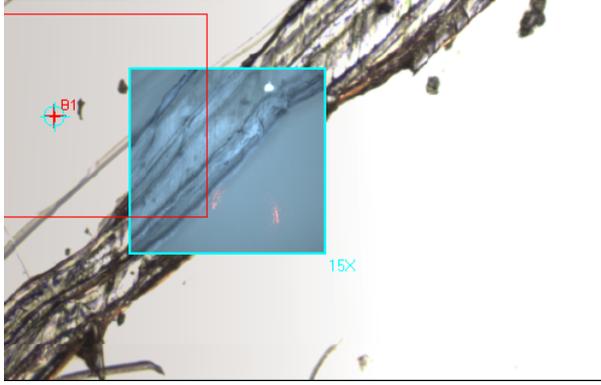
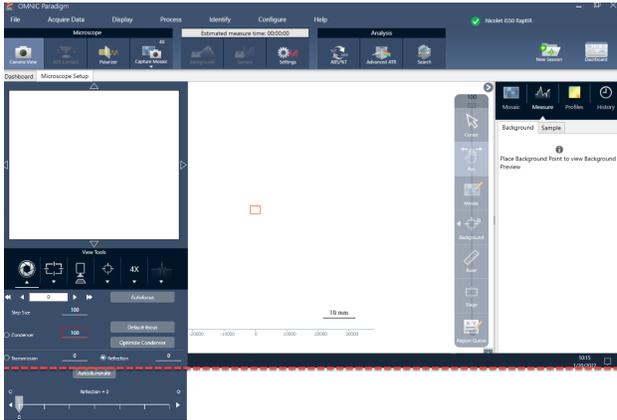
Lorsque les deux pièces sont installées et sécurisées, vous êtes prêt à ranger votre détecteur pour l'expédition.

[Contactez-nous](#) (ou contactez un représentant Thermo Fisher de votre région) pour savoir comment nous expédier vos détecteurs.

◆ Stockage des détecteurs

- Stockez vos détecteurs à température ambiante dans leur emballage d'origine. Placez-les sur une surface plane.
- Assurez-vous que les vases de Dewar du détecteur sont vides avant le stockage.
- Si votre détecteur n'est pas livré avec son emballage, ou si vous avez perdu votre emballage, veuillez [nous contacter](#) pour en faire la demande.

5. Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
<p>Les mosaïques 15x ne s'alignent pas toujours avec l'image 4x. Par exemple, sur l'image ci-dessous, l'image 15x n'est pas alignée avec l'image 4x.</p> 	<p>L'objectif est desserré.</p>	<p>L'objectif peut parfois se desserrer. Ceci se produit généralement lors de l'insertion et du retrait de l'accessoire ATR.</p> <p>Si l'objectif semble desserré, serrez-le à la main. La fente pour l'accessoire ATR doit être orientée directement vers l'avant.</p> <p>Ne serrez pas excessivement l'objectif, et n'utilisez pas l'accessoire ATR comme un levier pour serrer l'objectif. Tout serrage excessif de l'objectif risque de l'endommager.</p> <p>Si l'objectif semble correctement serré et que vous rencontrez toujours des problèmes d'alignement, contactez votre technicien de maintenance.</p>
<p>Certaines parties de l'interface du logiciel ne sont pas visibles à l'écran.</p> 	<p>Vos paramètres de mise à l'échelle de l'affichage ne sont pas compatibles avec le logiciel.</p>	<p>Si certaines parties de l'interface du logiciel n'apparaissent pas à l'écran, il peut être nécessaire de régler la mise à l'échelle de votre affichage dans les paramètres d'affichage du dispositif. Par exemple, sur certains moniteurs, les outils Caméra peuvent ne pas être visibles à l'écran si la mise à l'échelle de l'affichage est paramétrée à plus de 100 %.</p> <p>Pour obtenir de l'aide sur la modification de vos paramètres d'affichage, consultez l'aide de Windows.</p>
<p>La mosaïque ou la vue de la caméra sont complètement noires.</p>	<p>La caméra n'est pas connectée.</p>	<p>Vérifiez que le câble de la caméra est bien branché dans la tourelle porte-objectifs.</p> <p>Vérifiez que le câble USB du microscope est branché dans le connecteur USB 3.0.</p>

Problème	Cause possible	Solution
L'état du système affiche une icône jaune ou rouge.	Éventuel problème avec l'instrument ou les services logiciels.	Reportez-vous à la section État du système pour de plus amples informations.

6. Nous contacter

Pour obtenir une assistance technique, veuillez contacter : www.thermofisher.com

6.0.1 Commande de pièces

Pour commander des pièces, [contactez-nous](#).

Si vous devez nous expédier l'instrument ou un accessoire pour réparation, appelez-nous ou envoyez-nous un courriel au préalable pour connaître toute exigence relative à l'expédition, ou obtenir d'autres instructions.

6.0.2 Informations complémentaires

Pour trouver des guides et des tutoriels sur l'utilisation de votre microscope ou du logiciel OMNIC Paradigm, veuillez consulter la section [Base de connaissances](#).